

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีสปัตเตอริงสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ Research and Development of Titanium Nitride Films by Sputtering Method for Decorative Industrial.

โดย

นายสุรสิงห์ ไชยคุณ และคณะ

กรกฎาคม 2544

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัย

การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ด้วยวิธีสปัตเตอริงสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ Research and Development of Titanium Nitride Films by Sputtering Method for Decorative Industrial.

โดย

นายสุรสิงห์ ใชยคุณ

นายนิรันดร์ วิทิตอนันต์

นายสกุล ศรีญาณลักษณ์

นายจักรพันธ์ ถาวรธิรา

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสูญญากาศและฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

บทสรุปผู้บริหาร

การปรับปรุงผิววัสคุให้มีความคงทน ถาวรและสวยงามนั้น ทำได้หลายวิธีและวิธีที่ใช้กัน อย่างแพร่หลายคือ "การชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า (electroplating)" แต่วิธีนี้มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาก ทำให้มีการวิจัยและพัฒนาการเคลือบใหม่ขึ้นมาทดแทน คือ "การเคลือบในสุญญากาศ (vacuum deposition)" ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในภาชนะสุญญากาศเท่านั้น จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อ สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การเคลือบในสุญญากาศยังให้ผิวเคลือบที่มีคุณภาพสูงกว่าการชุบเคลือบด้วย ไฟฟ้าอีกด้วย ปัจจุบันได้มีการนำการเคลือบในสุญญากาศมาใช้งานอย่างกว้างขวาง

อุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณีเป็นอุตสาหกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย ที่มีการเคลือบเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลือบเพื่อความสวยงาม แต่จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการเคลือบเดิม ทำให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย ต้องหาวิธีการเคลือบใหม่ขึ้นมาทดแทน ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการหลายรายได้มีการนำเทคโนโลยี การเคลือบในสุญญากาสมาใช้แล้ว ซึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าเครื่องเคลือบในสุญญากาสที่มี ราคาสูงจากต่างประเทศทั้งสิ้น

ในส่วนของผิวเคลือบ (ฟิล์มบาง) ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี ให้ความสนใจ ได้แก่ ฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ เนื่องจากเป็นเซรามิคที่มีความเสถียรทางเคมีสูง ทนอุณหภูมิสูง มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานผิวต่ำ มีความแข็งสูง และที่สำคัญมีสีทอง ซึ่งถ้าหากนำ ไปเคลือบบนเครื่องประดับก็จะทำให้เครื่องประดับมีความสวยงามที่คงทนไม่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย

จากการสำรวจในเบื้องต้นของคณะผู้วิจัยพบว่า การศึกษา วิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับ เทคโนโลยีการเคลือบในสุญญากาศของประเทศไทยยังมีน้อยมาก ประกอบกับคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็น ความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ จึงเริ่มทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้โดยมี เป้าหมายหลักที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบในสุญญากาศนี้ขึ้นใช้เองภายในประเทศเพื่อทดแทน การนำเข้าจนสามารถพัฒนาเครื่องเคลือบในสุญญากาศระดับวิจัยขึ้นใช้เองได้เป็นผลสำเร็จ

ต่อมาคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม จึงได้เสนอโครงการ "การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ด้วยวิธีสปัตเตอริง สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ" ต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ฝ่าย 5) โดยมี บริษัท บางกอก แอสเสย์ ออฟฟิส จำกัด เป็นผู้ร่วมให้ทุนวิจัย ตามสัญญาเลขที่ RDG5/0004/2543 ซึ่งมี ระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน งบประมาณ 4,118,000 บาท แบ่งเป็นส่วนที่ขอรับการสนับสนุนจาก สกว. จำนวน 2,918,000 บาท (70.86%) และสมทบจาก บริษัท บางกอกแอสเสย์ ออฟฟิส จำกัด จำนวน 1,200,000 บาท (29.14%) วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ เพื่อสร้างต้นแบบเครื่องเคลือบ ฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ด้วยวิธีสปัตเตอริง และศึกษาการเคลือบและสมบัติของฟิล์มบางที่ได้

จากการศึกษา คณะผู้วิจัยสามารถสร้างต้นแบบเครื่องเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมในไตรด์ ด้วยวิธีสปัตเตอริง ตลอดจนศึกษาเทคนิคการเคลือบและสมบัติของฟิล์มบาง ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมี ผลการศึกษาโดยสรปดังนี้คือ

- 1. ต้นแบบเครื่องเคลือบที่สร้างขึ้นในโครงการนี้ใช้วัสดุส่วนใหญ่ที่มีในประเทศเป็นหลัก ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญ 7 ส่วน คือ (1) ภาชนะสญญากาศ (2) ระบบเครื่องสบสญญากาศ (3) คาโทค/ เป้าสารเคลือบ (4) ระบบน้ำหล่อเย็น (5) ระบบจ่ายไฟฟ้า (6) ระบบป้อนแก๊ส และ (7) ชุดควบคุมการ ทำงานของเครื่องเคลือบ โดยภาชนะสองกากสทำจากเหล็กกล้าสเตนเลส ทรงกระบอก มีเส้นผ่าสนย์ กลางขนาค 30.0 cm สง 31.0 cm (ปริมาตรประมาณ 22.0 ลิตร) ระบบเครื่องสบสฌฉากาศประกอบ ้ด้วยเครื่องแบบแพร่ไอและเครื่องสูบกลโรตารี คาโทดของเครื่องเคลือบสามารถติดตั้งได้ 2 ชุด เป็น แบบอันบาลานซ์ แมกนีตรอน มีพื้นที่เป้าสารเคลือบแบบแผ่นกลมขนาคเส้นผ่าสนย์กลาง 7.6 cm ติด ์ ตั้งแม่เหล็กชนิด NdFeB ไว้ด้านหลังเป้าสารเคลือบ มีความเข้มสนามแม่เหล็กบริเวณผิวเป้าสารเคลือบ ์ ที่ขอบและกลางคาโทคประมาณ 1,000 gauss และ 490 gauss ตามลำคับ ระบบน้ำหล่อเย็นใช้สำหรับ หล่อเย็นคาโทค เป้าสารเคลือบและเพลตวาล์วของเครื่องสบแพร่ใอ ระบบจ่ายไฟฟ้าเป็นระบบแปลง ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง แบบฟูลเวฟ ขนาดอินพุท 220 V เอาท์พุทไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 1-3 A มี ความต่างศักย์ในช่วง 0-1,000 $oldsymbol{\mathrm{V}}$ มีชดควบคมการใหลแก๊สอย่างละเอียดสำหรับป้อนแก๊ส ชดควบคม การทำงานของเครื่องเคลือบเป็นระบบนิวเมติกส์ทั้งหมด เครื่องเคลือบต้นแบบที่สร้างขึ้นสามารถลด ความคันภายในภาชนะสุญญากาศได้ต่ำสุด $8.0\mathrm{x}10^{-6}\,\mathrm{mbar}$ ในเวลา $60\,\mathrm{u}$ าที่ และสามารถเคลือบฟิล์ม โลหะชนิดต่างๆ ได้ตามวัตถประสงค์
- 2. การเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ในโครงการนี้ใช้วิธี รีแอคตีฟ สปัตเตอริง ใช้ ไททาเนียมเป็นเป้าสารเคลือบ มีแก๊สอาร์กอนเป็นสปัตเตอร์แก๊สและแก๊ส ใน โตรเจนเป็นรีแอคตีฟ แก๊ส เครื่องเคลือบต้นแบบที่สร้างขึ้นในโครงการสามารถเคลือบฟิล์มไททาเนียมในไตรด์ที่มีสีทอง สวยงามบนวัสคุรองรับชนิดต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้พบเฟสของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ 2 เฟส คือ TiN(111) ที่มุม $20 \approx 36.71^\circ$ และ TiN(200) ที่มุม $20 \approx 42.65^\circ$ และมีความแข็งประมาณ 3.23-5.27 GPa โดยในส่วนของการยึดติดของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์บนวัสคุรองรับชนิดต่างๆ จะ เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของวัสคุรองรับก่อนเคลือบ เมื่ออุณหภูมิของวัสคุรองรับสูงขึ้น การยึด ติดของฟิล์มบางที่เคลือบได้จะมีการยึดติดดีขึ้น

Executive Summary

Surface improvement techniques have various methods. Many industries use electroplating technique to deposit thin film onto the surface in aqueous solution that has toxic problems in the environments. From this problems the research of the new technology is occurred.

The researchers are interested in vacuum deposition technologies especially, sputter deposition technique. Because this process is non-toxic process that produces higher quality of thin film than one obtains from the electroplating technique. Nowadays, this technique is widely used in many industries around the world.

Gem and jewelry industries are one of the most important industries of Thailand that use the surface improvement processes in their line of production for decorative products. All of them use the electroplating technique that has the environmental problems then they are searching for the new technology to solve these problems. Some of them import vacuum coating technologies from foreign countries that have expensive costs.

The jewelers are interested in thin film of titanium nitride. Because it has high chemical stability, high temperature stability, low surface friction, high hardness, non tarnishing and gold color film. If we coat this film onto the jewelry we obtain all advantage properties on the surface of this jewelry.

From our first investigation we find that the research and development on the vacuum technology of coating in Thailand is at least. And our vision is focus on the important of this technology for the development of our country. We have done the research of this technology for the main point to reduce importing this technology from aboard. Now we success in the development of the research scale coating system from our own technologies.

The next concept of us is the application of this process from research scale develops to industrial scale we propose the research project "Research and Development of Titanium Nitride Films by Sputtering Method for Decorative Industral" to the Thailand Research Fund (TRF) for the main funding. And we have co-funding from the Bangkok Assay Office limited (BAO). We have contract number RDG5/0004/2543 of the project for 18 months in 4,118,000 bahts (from the TRF 2,918,000 bahts (70.86%) and from the BAO 1,200,000 bahts (29.14%)). The main objective of this research is the prototype of the industrial scale coating system that can deposit titanium-nitride thin film by reactive sputtering technique and study in know-how and properties of the film that we obtain from this coating system.

The results of this research are the prototype of the industrial scale coating system and the know-how of this method and the properties of titanium-nitride film that can summarize below.

- 1. The prototype is made from material in Thailand that has 7 main parts are (1) vacuum vessel (2) vacuum pumping system (3) cathode and target system (4) water cooling system (5) DC power regulator system (6) gas flow controller system and (7) main controller coating system. The vacuum vessel is made from cylindrical stainless steel that has 30.0 cm in diameter and 31.0 cm in height (volume approximate 22.0 litres). The vacuum pumping system is an accessory to oil diffusion pump and rotary pump. In this system we can install 2 unbalanced magnetron sputtering cathode that has 7.6 cm diameter target. We enter NdFeB permanent magnets within the backing plate of the cathode. The magnetic field intensity is measured about 1000 gauss at the center of the target and 490 gauss at the edge of the target. The cooling system is cooled the cathode and vapor trap between plate valve and diffusion pump. The DC regulator is full-wave system that transfroms 220 voltage input into 1-3 A 0-1000 volts output. The gas flow controller system can adjust the rate of flow of gas precisely. The main controller controls the process automatically by pneumatic system. The prototype can reduce the pressure within the vacuum vessel from atmosphere to 8.0x10⁻⁶ mibar in 60 minutes and can deposit all kinds of metal films.
- 2. In this research we deposit the titanium-nitride thin film by reactive magnetron sputtering method. We use pure solid titanium as a target, argon gas as sputter gas and nitrogen gas as reactive gas. From our system with suitable conditions we obtain gold color film onto various kinds of substrates. From X-ray diffractometer we find 2 phase of TiN that TiN(111) at diffraction angle 36.71° and TiN(200) at diffraction angle 42.65°. From nano-indenter we find the film nanohardness at 3.23-5.27 GPa. And from the scratched proof experiments we find that the adhesion of the film to substrate depend on the substrate temperature as deposition. If we deposit at high substrate temperature the film is better adhesive than at low substrate temperature.

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถประสงค์หลัก เพื่อสร้างต้นแบบเครื่องเคลือบฟิล์มบาง ใทเทเนียมในใตรค์ค้วยวิธี สปัตเตอริง ตลอคจนศึกษากระบวนการเคลือบและสมบัติของฟิล์มบางที่ เคลือบได้ ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้คือ

คันแบบเครื่องเคลือบที่สร้างขึ้นมีส่วนประกอบสำคัญ 7 ส่วน คือ (1) ภาชนะสญญากาศ (2) ระบบเครื่องสบสฌฉากาศ (3) คาโทค/เป้าสารเคลือบ (4) ระบบน้ำหล่อเย็น (5) ระบบจ่ายไฟฟ้า (6) ระบบป้อนแก๊ส และ (7) ชคควบคุมการทำงานของเครื่องเคลือบ โดยภาชนะสุณญากาศ ทำจาก เหล็กกล้าสเตนเลส ทรงกระบอก มีเส้นผ่าสนย์กลางขนาด 30.0 cm สง 31.0 cm (ปริมาตร 22.0 ลิตร) ระบบเครื่องสูบสุญญากาศประกอบด้วยเครื่องแบบแพร่ไอและเครื่องสูบกลโรตารี คาโทดของเครื่อง เคลือบติดตั้ง ได้ 2 ชุด เป็นแบบอันบาลานซ์ แมกนีตรอน มีพื้นที่เป้าสารเคลือบแบบแผ่นกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 7.6 cm ติดตั้งแม่เหล็กชนิด NdFeB ไว้ด้านหลังเป้าสารเคลือบ มีความเข้มสนามแม่ เหล็กบริเวณผิวเป้าสารเคลือบที่ขอบและกลางคาโทคประมาณ 1,000 gauss และ 490 gauss ตามลำคับ ระบบน้ำหล่อเย็นใช้สำหรับหล่อเย็นคาโทค เป้าสารเคลือบและเพลตวาล์วของเครื่องสูบแพร่ไอ ระบบ จ่ายไฟฟ้าเป็นระบบแปลงไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง แบบฟูลเวฟ ขนาดอินพุท 220 ${f v}$ เอาท์พุทไฟฟ้า กระแสตรงขนาด 1-3 ${f A}$ มีความต่างศักย์ในช่วง 0-1,000 ${f V}$ มีชดควบคมการ ใหลแก๊สอย่างละเอียด สำหรับป้อนแก๊ส ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องเป็นระบบนิวเมติกส์ทั้งหมด เครื่องเคลือบต้นแบบ ์ ที่สร้างขึ้นสามารถลดความคันภายในภาชนะสฌญากาศได้ต่ำสด 8.0x10 ⁻⁶ mbar ในเวลา 60 นาที และ สามารถเครือบฟิล์มบางโลหะชนิดต่างๆ ได้ตามวัตถประสงค์

การเคลือบฟิล์มบางใททาเนียมในใตรด์ในโครงการนี้ใช้วิธี รีแอคตีฟ สปัตเตอริง โดยใช้ ไททาเนียมเป็นเป้าสารเคลือบ มีแก๊สอาร์กอนเป็นสปัตเตอร์แก๊สและแก๊ส ใน โตรเจนเป็นรีแอคตีฟ แก๊ส เครื่องเคลือบต้นแบบที่สร้างขึ้นในโครงการสามารถเคลือบฟิล์มไททาเนียมในไตรด์ที่มีสีทอง สวยงามบนวัสคุรองรับชนิดต่างๆ ได้วัตถุประสงค์ ทั้งนี้พบเฟสของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์ 2 เฟส คือ TiN(111) ที่มุม $20 \approx 36.71^\circ$ และ TiN(200) ที่มุม $20 \approx 42.65^\circ$ และมีความแข็งประมาณ 3.23-5.27 GPa โดยในส่วนของการยึดติดของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์บนวัสครองรับชนิดต่างๆ จะ เปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของวัสคุรองรับก่อนเคลือบ เมื่ออุณหภูมิของวัสคุรองรับสูงขึ้น การยึด ติดของฟิล์มบางที่เคลือบได้จะมีการยึดติดดีขึ้น

ABSTRACT

The main objective of this research is the prototype of the industrial scale coating system that can deposit titanium-nitride thin film by reactive sputtering technique and study in know-how and properties of the film that we obtain from this coating system. The results of this research are the prototype of the industrial scale coating system and the know-how of this method and the properties of titanium-nitride film that can summarize below.

The prototype is made from material in Thailand that has 7 main parts are (1) vacuum vessel (2) vacuum pumping system (3) cathode and target system (4) water cooling system (5) DC power regulator system (6) gas flow controller system and (7) main controller coating system. The vacuum vessel is made from cylindrical stainless steel that has 30.0 cm in diameter and 31.0 cm in heigth (volume approximate 22.0 litres). The vacuum pumping system is an accessory to oil diffusion pump and rotary pump. In this system we can install 2 unbalanced magnetron sputtering cathode that has 7.6 cm diameter target. We enter NdFeB permanent magnets within the backing plate of the cathode. The magnetic field intensity is measured about 1000 gauss at the center of the target and 490 gauss at the edge of the target. The cooling system is cooled the cathode and vapor trap between plate valve and diffusion pump. The DC regulator is full-wave system that transfroms 220 voltage input into 1-3 A 0-1000 volts output. The gas flow controller system can adjust the rate of flow of gas precisely. The main controller controls the process automatically by pneumatic system. The prototype can reduce the pressure within the vacuum vessel from atmosphere to 8.0x10⁻⁶ mibar in 60 minutes and can deposit all kinds of metal films.

In this research we deposit the titanium-nitride thin film by reactive magnetron sputtering method. We use pure solid titanium as a target, argon gas as sputter gas and nitrogen gas as reactive gas. From our system with suitable conditions we obtain gold color film onto various kinds of substrates. From X-ray diffractometer we find 2 phase of TiN that TiN(111) at diffraction angle 36.71° and TiN(200) at diffraction angle 42.65°. From nano-indenter we find the film nanohardness at 3.23-5.27 GPa. And from the scratched proof experiments we find that the adhesion of the film to substrate depend on the substrate temperature as deposition. If we deposit at high substrate temperature the film is better adhesive than at low substrate temperature.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการ "การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ด้วยวิธีสปัตเตอริง สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ: Research and Development of Titanium Nitride Films by Sputtering Method for Decorative Industrial." เป็น โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จาก ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตามสัญญาเลขที่ RDG5/0004/2543 ในชุด โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดย มี บริษัท บางกอก แอสเสย์ ออฟฟิส จำกัด เป็นผู้ร่วมให้ทุนวิจัย มีระยะเวลาดำเนินงาน 18 เดือน และ มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างต้นแบบเครื่องเคลือบฟิล์มไทเทเนียมในไตรด์ด้วยวิธี สปัตเตอริง ตลอดจนศึกษากระบวนการเคลือบฟิล์มบางและสมบัติของฟิล์มบางที่ได้

โครงการวิจัยและพัฒนานี้คงไม่สามารถดำเนินการจนสำเร็จได้ หากไม่ได้รับความ อนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ ได้แก่ รศ.คร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อ.เอกชัย หุ่นนิวัฒน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, รศ.อรุณีย์ อินทศร และ อ.มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาสาสตร์ มหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ สำหรับ การให้ความอนุเคราะห์ฟิล์มบางด้วยเทคนิค XRD และ อ.สุริยา โชคสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่าย วิจัยและบริการ คณะวิสวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับการให้ความอนุเคราะห์ใน การใช้เครื่องวัดความแข็งระดับนาโน

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน คือ รศ.คร.ณสรรค์ ผลโภค ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ผศ.คร.ประสงค์ ศรีเจริญชัย หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมโลหะการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สละเวลาในการตรวจเยี่ยมและ ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับการคำเนินโครงการแก่คณะผู้วิจัยตลอดโครงการ

โครงการนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการวิจัย คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ คุณพิเชษฐ พะถานุกูล ประชานกรรมการ บริหาร บริษัท บางกอก แอสเสย์ ออฟฟิส จำกัด ที่ร่วมให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนี้แก่คณะผู้วิจัย จน สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมกันนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คร.จรูญ คำนวณตา (ผู้อำนวยการฝ่าย 5) และ รศ.คร.ทวีป ศิริรัศมี (ผู้ประสานงานโครงการ) สำหรับความช่วย เหลือในการประสานงานและคำแนะนำต่างๆ ท้ายที่สุดคณะผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.คร.พิเชษฐ ลิ้ม สุวรรณ สำหรับการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับเทคนิคการเคลือบ ตลอดจนคำ แนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะผู้วิจัยตลอดมา

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	i
Executive Summary	ii
บทคัดย่อ	v
ABSTRACT	vi
กิตติกรรมประกาศ	vii
สารบัญ	viii
สารบัญตาราง	xii
สารบัญรูป	xiii
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของการวิจัย	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	6
1.3 แนวทางและวิธีดำเนินงานโดยย่อ	6
1.4 ขอบเขตของโครงการ	8
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ	8
บทที่ 2 ทฤษฎี	9
2.1 ระบบสุญญากาศ	9
2.1.1 ธรรมชาติของสุญญากาศ	9
2.1.2 หน่วยวัดความคัน	11
2.1.3 ระยะปลอดการชน (Mean Free Path)	12
2.1.4 ส่วนประกอบของระบบสุญญากาศ	12
2.1.5 ปริมาณของแก๊สและแรงขับ	14
2.1.6 การวัดความดันในระบบสุญญากาศ	15
2.2 เทคโนโลยีฟิล์มบาง	16
2.2.1 กระบวนการเคถือบฟิล์มบาง	16
2.2.2 การก่อเกิดฟิล์มบาง	17
2.2.3 ประเภทของการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ	18
2.2.4 การเคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์	19

		หน้า
2.3	การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิชีสปัตเตอริง	20
	2.3.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสปัตเตอริง	20
	2.3.2 โกลว์ดิสชาร์จ	27
	2.3.3 ระบบเคลือบแบบ ดีซี สปัตเตอริง	32
	2.3.4 ระบบเคลือบแบบ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง	34
	2.3.5 ระบบเคลือบแบบ อันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง	38
2.4	อุปกรณ์ในระบบ แมกนีตรอน สปัตเตอริง	40
	2.4.1 คาโทดและเป้าสารเคลือบ	40
	2.4.2 ที่วางชิ้นงาน	43
	2.4.3 ระบบสุญญากาศ (vacuum system)	45
	2.4.4 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า (power supply)	46
	2.4.5 ระบบป้อนแก๊ส	47
2.5	ลักษณะเฉพาะตัวของระบบสปัตเตอริง	48
	2.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแส ความต่างศักย์คิสชาร์จและความคัน	48
	2.5.2 อัตราเคลือบและประสิทธิภาพการเคลือบ	49
	2.5.3 ขีดจำกัดของอัตราเคลือบ	50
2.6	การเคลือบแบบ รีแอคทีฟ สปัตเตอริง (reactive sputtering method)	50
	2.6.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเคถือบด้วยวิชี รีแอคทีฟ สปัตเตอริง	50
	2.6.2 ปัญหาทาร์เกต พอยซันนิง ของการเคลือบด้วยวิธี รีแอคทีฟ สปัตเตอริง	52
	2.6.3 การแก้ปัญหาของการเคลือบด้วยวิชี รีแอคทีฟ สปัตเตอริง	55
2.7	สมบัติ โครงสร้าง และการใช้งานของไททาเนียมในไตรค์	60
	2.7.1 สีและโครงสร้างสารประกอบของไททาเนียมในไตรค์	60
	2.7.2 ความด้านทานและโครงสร้างของไททาเนียมในใตรด์	62
	2.7.3 ความแข็งและทนต่อการสึกหรอของไททาเนียมในไตรค์	62
	2.7.4 สมบัติอื่นๆ ของไททาเนียมในไตรค์และการประยุกต์ใช้งาน	63
2.8	การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง	65
	2.8.1 เทคนิคการเกี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (X-ray Diffraction)	66
	2.8.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microsc	opy)68
	283 เพลบโลการกลระลับบาโบเบลร (Nancindentation Technique)	70

		หน้า
บทที่ 3	การออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องเคลือบ	73
	3.1 เครื่องเคลือบฟิล์มบางที่สร้างขึ้นในช่วงแรก	73
	3.2 การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบ	75
	3.2.1 ภาชนะสุญญากาศ	76
	3.2.2 ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ	79
	3.2.3 คาโทดและเป้าสารเคลือบ	81
	3.2.4 ระบบน้ำหล่อเย็น	83
	3.2.5 ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง	84
	3.2.6 ระบบป้อนแก๊ส	85
	3.2.7 ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องเคถือบ	86
	3.3 การทดสอบระบบสุญญากาศของเครื่องเคลือบ	89
	3.3.1 ความดันต่ำสุดของเครื่องเคถือบเมื่อใช้เฉพาะเครื่องสูบกลโรตารี	90
	3.3.2 ความดันต่ำสุดของเครื่องเคถือบเมื่อใช้เครื่องสูบแบบแพร่ใอ	91
	3.4 การทดสอบการเคลือบฟิล์มบาง	92
	3.5 การทดสอบ แมกนีตรอน คาโทดของเครื่องเคลือบ	94
	3.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์แมกนีตรอน คาโทด	94
	3.5.2 การทคสอบหาระยะที่มีการกระจายตัวของสารเคลือบดีที่สุด	97
	3.5.3 การทดสอบการกระจายตัวของสารเคลือบ	100
	3.5.4. การหาอัตราเคลือบของเครื่องเคลือบ	102
บทที่ 4	การศึกษาการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์	104
	4.1 แนวคิดเกี่ยวกับการเคถือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์	104
	4.2 การทดลองการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์นำร่อง	105
	4.2.1 การศึกษาการเตรียมฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์106	
	4.2.2 การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราไหลของแก๊สในโตรเจนต่อสีของ	
	ฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์	109
	4.2.3 การทดลองเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์บนวัสดุรองรับชนิดต่างๆ	111
	4.3 การศึกษาการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์ด้วยเครื่องเคลือบค้นแบบ	112
	4.3.1 การศึกษาการเตรียมฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์	113
	4.3.2 การศึกษาสีของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์กับ	
	อัตราไหลของแก๊สในโตรเจน	114

	หน้า
4.3.3 การทดลองเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์บนวัสดุรองรับชนิดต่างๆ	116
4.3.4 การทดลองเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์บนเครื่องประดับ	117
4.4 การศึกษาสมบัติของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์	119
4.4.1 การศึกษาเฟสของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์	120
4.4.2 การศึกษาความแข็งระดับนาโนของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์	123
4.4.3 การศึกษาผลของอุณหภูมิวัสคุรองรับต่อการยึคติด	
ของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์	125
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ	127
5.1 สรุปผลการศึกษา	127
5.1.1 การออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบค้นแบบ	127
5.1.2 ผลการทคสอบเครื่องเคลือบต้นแบบ	128
5.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเคถือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์	129
5.1.4 การศึกษาการเคถือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์	130
5.1.5 การศึกษาสมบัติของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์	131
5.2 ข้อเสนอแนะ	131
5.2.1 ข้อเสนอแนะในส่วนเครื่องเคลือบฟิล์มบางต้นแบบ	131
5.2.2 ข้อเสนอแนะในส่วนการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์	132
เอกสารอ้างอิง	133
ภาคผนวก	
ก. การสร้างภาวะสุญญากาศในภาชนะสุญญากาศ	138
ข. ขั้นตอนการเคลื่อบฟิล์มบาง	142
ค. รูปแบบการเกี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของไททาเนียมในไตรค์	145
ง. ประวัตินักวิจัย	148

สารบัญตาราง

ฅารางที่		หน้า
2.1	องค์ประกอบของอากาศที่ระดับน้ำทะเล	10
2.2	การจำแนกองศาแห่งสุญญากาศ ตามความดันภายในระบบ	11
2.3	พลังงานขีดเริ่มของเป้าสารเคลือบชนิดต่างๆ	23
2.4	ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใหลของน้ำหล่อเย็นเมื่อใช้กำลังไฟฟ้าค่าต่างๆ	
	ที่ความแตกต่างอุณหภูมิน้ำเข้าและน้ำออกของระบบหล่อเย็นไม่เกิน $10^{\circ}\mathrm{C}$	41
2.5	เทคนิคสำหรับการวิเคราะห์ลักษณะทางโครงสร้างของฟิล์มบาง	66
3.1	ผลการเคลือบฟิล์มบางที่เคลือบได้จากเครื่องต้นแบบ	93
3.2	ค่า k และ ค่า n ของเครื่องเคลือบที่ความดันต่างๆ	95
3.3	ความหนาของฟิล์มทองและไททาเนียมที่ตำแหน่งต่างๆ	101
4.1	สีของฟิล์มไททาเนียมในไตรด์ที่อัตราไหลของแก๊สอาร์กอน	
	และแก๊สในโตรเจนต่างกัน	108
4.2	สีของฟิล์มไททาเนียมในไตรด์ที่อัตราไหลของแก๊สในโตรเจนต่างๆ	110
4.3	ผลการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ที่อัตราไหลของแก๊สในโตรเจนต่าง	เกัน114
4.4	สีของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ที่อัตราไหลของแก๊สในโตรเจนต่างกัน	115
4.5	ความแข็งของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ที่เคลือบบนสเตนเลส	124
4.6	การยึดติดของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์บนวัสคุรองรับชนิดต่างๆ	
	ที่อุณหภูมิวัสคุรองรับต่างกัน	126

สารขัญรูป

รูปที่		หน้า
2.1	การเคลื่อนที่ของโมเลกุลแก๊สในภาชนะปิด	10
2.2	ผังการทำงานของระบบสุญญากาศที่มีความดัน 10-3-10-7 mbar	13
2.3	การไหลของแก๊สในระบบสุญญากาศ	14
2.4	การก่อเกิดฟิล์มบาง	17
2.5	ประเภทของกระบวนการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ	19
2.6	อันตรกิริยาระหว่างไอออนและผิวเป้าสารเคลือบ	21
2.7	ชีลด์ของทองแดงที่ถูกชนด้วยไอออนจากแก๊สอาร์กอนที่พลังงานต่างๆ	23
2.8	การเปลี่ยนแปลงค่ายีลด์ของเป้าทองแดง (Cu) , เงิน (Ag) และแทนทาลัม (Ta)	
	เมื่อใช้ไอออนพลังงาน 45 keV จากธาตุที่มีเลขอะตอมค่าต่างๆ	24
2.9	การเปลี่ยนแปลงของยีลค์เมื่อใช้ใอออนของปรอทพลังงาน 200 eV	
	ชนเป้านิเกิล (Ni), โมลิบดินัม (Mo) , ทั้งสเตน (W) และทองคำขาว (Pt)	
	ที่มุมการตกกระทบค่าต่างๆ (วัดเทียบกับแนวชนตั้งฉากบนเป้า)	25
2.10	(a) การกระจายค่าพถังงานของอะตอมทองแคงที่ถูกสปัตเตอร์จากไอออน	
	ของแก๊ส Kr ที่พลังงานต่างๆ	
	(b) เปรียบเทียบการกระจายค่าความเร็วของอะตอมทองแดงที่ได้จากการระเหยส	ารและ
	จากการสปัตเตอริง	26
2.11	(a) พลังงานเฉลี่ยของอะตอมสารเคลือบที่มีค่าเลขอะตอมต่างๆ	
	เมื่อถูกชนด้วยไอออนของไอออนของ Kr พลังงาน 1200 eV ที่พลังงานต่างๆ	
	(b) ความเร็วเฉลี่ยของอะตอมสารเคลือบที่มีค่าเลขอะตอมต่างๆ	
	เมื่อถูกชนค้วยไอออน Kr พลังงาน 1200 eV	26
2.12	ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นกระแสและแรงคันไฟฟ้าระหว่างขั้วอิเล็กโตรด	
	ของกระบวนการเกิด ดีซี โกลว์ดิสชาร์จ ในหลอดสุญญากาศบรรจุแก๊สนีออน	28
2.13	ความสัมพันธ์ระหว่างแรงคันไฟฟ้าทะถายและผลคูณระหว่างความคัน (p)	
	และระยะระหว่างอิเล็กโตรด (d)	29
2.14	โกลว์ดิสชาร์จ ของหลอดแก๊สนีออนยาว 50 cm ที่ความคัน 1.33 mbar	30
2.15	ระบบสปัตเตอริงแบบ ดีซี สปัตเตอริง	32
2.16	ผลของความดันในระบบที่มีผลต่ออัตราเคลือบ ค่ายีลด์และกระแสไฟฟ้า	
	ในระบบสปัตเตอริงของนิเกิลที่ใช้แรงคันไฟฟ้า 3,000 V ระหว่างขั้วอิเล็กโตรด	
	ที่วางห่างกัน 4.5 cm	33

รูปที่		หน้
2.17	การเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก	34
2.18	การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามต่างๆ โดยที่	
	a , b , c เป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กอย่างเคียว	
	ส่วน d และ e เป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กและสนามไท	lฟ้า
	ร่วมกันในลักษณะต่างๆ	36
2.19	การจัดสนามแม่เหล็กและแนวการกัดกร่อนของเป้าสารเคลือบ	
	ในระบบพลานาร์แมกนีตรอน สปัตเตอริง	37
2.20	ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กของระบบอันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง	38
2.21	ลักษณะพลาสมาของระบบสปัตเตอริง	
	(a) ระบบบาลานซ์แมกนีตรอน สปัตเตอริง	
	(b) ระบบอันบาลานซ์แมกนีตรอน สปัตเตอริง	39
2.22	โครงสร้างอาโนคหรือที่วางชิ้นงาน ที่ควบคุมอุณหภูมิใค้	44
2.23	(a) ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์คิสชาร์จของพลานาร์	
	แมกนีตรอนคาโทดรูปสี่เหลี่ยม ที่ความดันค่าต่างๆ	
	(b) ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ดิสชาร์จ และความดันเมื่อกระแสคงที่	49
2.24	ระบบการเคลือบฟิล์มบางโดยวิชี รีแอคทีฟ สปัตเตอริง	50
2.25	เทคนิคการป้อนแก๊สไวปฏิกิริยาเพื่อลดปัญหา target poisoning	
	ในระบบการเคลือบโดยวิชี รีแอคทีฟ สปัตเตอริง	52
2.26	ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าดิสชาร์จ และอัตราเคลือบที่ค่ากำลังไฟฟ้า	
	และความคันแก๊สผสมคงที่ เมื่อเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลของรีแอคทีฟแก๊ส	53
2.27	ฮีสเตอรีซีสของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราไหลของแก๊สในโตรเจน และ	
	ค่าความดันย่อยของแก๊สในโตรเจนในระบบ จากการทำรีแอคทีฟ สปัตเตอริง	
	ของสารประกอบในไตรด์ เมื่อค่าของกำลังไฟฟ้าและความคันรวมคงที่	54
2.28	กราฟฮีสเตอรีซีสของการเคลือบสารประกอบของไททาเนียม	
	(a) ขณะ ไม่มีการควบคุมความคันย่อยของรีแอคทีฟแก๊ส	
	(b) ขณะที่มีการควบคุมความคันย่อยของรีแอคทีฟแก๊ส	56
2.29	ลักษณะแรงคันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลส์สมมาตร	58
2.30	ลักษณะการทำงานของระบบเคลื่อบแบบ 2 คาโทด	
	เมื่อต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลส์สมมาตร	58
2 3 1	ลักษณะแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบพัลส์อสมมาตร	59

รูปที่		หน้า
2.32	ลักษณะการทำงานของระบบเมื่อต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง	
	แบบพัลส์อสมมาตร	59
2.33	อันตรกิริยาของอนุภาคกับวัสดุ	65
2.34	(a) เอกซ์เรย์ คิฟแฟรกโตมิเตอร์ (X-ray diffractometer)	
	(b) Intensity peak ที่แสดงถึงระนาบผลึกของวัสดุในตำแหน่งที่มีการหักเหรังสี	67
2.35	เส้นทางการเคลื่อนที่ของลำอิเลกตรอนบนผิวชิ้นงานในกล้อง SEM	69
2.36	กราฟของภาระที่เป็นฟังก์ชั่นของความลึกในการกด	71
2.37	ลักษณะทางกายภาพของการกดภายในฟิล์มบาง	72
3.1	เครื่องเคลือบที่สร้างเสร็จในช่วงแรก (ก่อนปรับปรุง)	74
3.2	เครื่องเคลือบที่สร้างเสร็จในตอนแรกขณะติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบสุญญากาส	74
3.3	ชุดควบคุมและภาคจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเคลือบที่สร้างในตอนแรก	75
3.4	เครื่องเคลือบทั้งระบบที่ออกแบบและสร้างขึ้นในโครงการนี้	75
3.5	ภาชนะสุญญากาศของเครื่องเคถือบ	76
3.6	ภายในภาชนะสุญญากาศของเครื่องเคลือบ	77
3.7	ด้านบนของแผ่นฐานของเครื่องเคลือบ	77
3.8	ด้านถ่างของแผ่นฐานของเครื่องเคถือบ ซึ่งมีชุดหมุนที่วางชิ้นงานสำหรับเคถือบ	77
3.9	แท่นวางชิ้นงานและที่จับชิ้นพร้อมแกนสำหรับหมุน	78
3.10	ชุดให้ความร้อนแบบอินฟราเรด	78
3.11	ชุดให้ความร้อนแบบอินฟราเรดเมื่อติดตั้งภายในภาชนะสุญญากาส	78
3.12	เครื่องสูบแบบแพร่ไอของระบบสุญญากาศของเครื่องเคลือบ	79
3.13	เครื่องสูบกลโรตารีของระบบสุญญากาศของเครื่องเคลือบ	80
3.14	การติดตั้งเครื่องสูบแบบแพร่ไอและเครื่องสูบกลโรตารีของเครื่องเคลือบ	80
3.15	วาล์วที่ออกแบบและสร้างขึ้นใช้เองในโครงการ	
	(a) เพลตวาล์วที่ต่อ ไปยังเครื่องสูบแบบแพร่ ใอของเครื่องเคลือบ	
	(b) วาล์วปล่อยอากาศเข้าสู่ภาชนะสุญญากาศ	80
3.16	(a) ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ ของคาโทค	
	(b) คาโทดที่ประกอบเรียบร้อยแล้ว	82
3.17	(a) การติดตั้งคาโทคเมื่อมองจากด้านในภาชนะสุญญากาศ	
	(b) การติดตั้งคาโทคเมื่อมองจากด้านหลังเครื่องเคลือบ	82
3.18	โกลว์ดีสชาร์จบริเวณหน้าคาโทค ขณะสปัตเตอริง	82
3.19	ระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องเคลือบ	83

รูปที่		หน้า
3.20	ระบบจ่ายใฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงของเครื่องเคลือบ	84
3.21	หม้อแปลงไฟฟ้าของระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเคลือบ	84
3.22	ถึงแก๊สและระบบป้อนแก๊สของเครื่องเคลือบ	85
3.23	ชุดควบคุมการปล่อยแก๊ส ชุคมาตรวัดความดันและวัดอุณหภูมิ	85
3.24	ชุดควบคุมระบบการทำงานของเครื่องเคถือบ	86
3.25	ชุดควบคุมการทำงานของระบบสุญญากาศของเครื่องเคถือบ	86
3.26	ชุดควบคุมการเคลือบของเครื่องเคลือบ	87
3.27	การติดตั้งชุดควบคุมการทำงานของเครื่องเคถือบ	87
3.28	การติดตั้งชุดควบคุมนูเมติกส์ของเครื่องเคลือบ	87
3.29	ตัวอย่างอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นใช้เองในโครงการ	88
3.30	ขั้วไฟฟ้าสุญญากาศที่สร้างขึ้นใช้เองในโครงการ	88
3.31	ฟรีดทรูปลั๊กที่สร้างขึ้นใช้เองในโครงการ	88
3.32	แผนภาพของระบบสุญญากาศของเครื่องเคลือบ	89
3.33	ผลการทคสอบระบบสุญญากาศของเครื่องเคลือบเมื่อใช้เฉพาะเครื่องสูบกลโรต	การี 90
3.34	ผลการทดสอบความดันต่ำสุดของเครื่องเคลือบเมื่อใช้เครื่องสูบแบบแพร่ไอ	92
3.35	ฟิล์มบางทองและฟิล์มบางไททาเนียมที่เคลือบได้	93
3.36	ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์ ที่ความดันต่างๆ	
	เมื่อใช้ทองแคงเป็นเป้าสารเคลือบ	96
3.37	ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์ ที่ความดันต่างๆ	
	เมื่อใช้ไททาเนียมเป็นเป้าสารเคลือบ	96
3.38	แผนภาพภาชนะสุญญากาศของเครื่องเคลือบและการวางวัสคุรองรับ	97
3.39	การวางกระจกปิดสไลด์เพื่อหาการกระจายตัวของสารเคลือบ	97
3.40	ลักษณะการกระจายตัวของสารเคลือบที่ระยะ	
	ระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับต่างๆ	99
3.41	ลักษณะการกระจายตัวของสารเคลือบที่ตำแหน่งต่างๆ	101
3.42	การวางกระจกปิดสไลค์เพื่อทดลองหาอัตราเคลือบ	102
3.43	อัตราเคลือบของฟิล์มทองแดงและไททาเนียมที่ระยะ 10.0 cm จากเป้าสารเคลือ	บ 103
4.1	เครื่องเคลือบระดับวิจัยที่ใช้ในการศึกษานำร่อง	105
4.2	ฟิล์มไททาเนียมในไตรค์ที่เคถือบได้	
	(a) ฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราใหลของแก๊สอาร์กอนและในโตรเจนต่างกัน	
	(b) สีของฟิล์มที่เคลือบบนกระจกส ใลด์ (แถวบนค้านหน้า/แถวล่างค้านหลัง)	108

รูปที่		หน้า
4.3	สีของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์ที่เคลือบค้วยอัตราไหล	
	ของแก๊สในโตรเจนต่างกัน	110
4.4	ผลการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์บนวัสคุต่างๆ	111
4.5	เครื่องเคลือบต้นแบบที่ใช้ในการทดลองการเคลือบฟิล์มบาง	112
4.6	ฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ที่เคลือบด้วยอัตราไหลของแก๊สในโตรเจนต่างกัน	114
4.7	ฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ที่เคลือบด้วยอัตราไหลของแก๊สในโตรเจนต่างกัน	115
4.8	ผลการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์บนวัสคุต่างๆ	116
4.9	ผลการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์บนเครื่องประดับที่มีผิวเรียบ	117
4.10	ผลการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์บนเครื่องประดับที่มีผิวโค้ง	118
4.11	ผลการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์บนเครื่องประดับที่ผิวไม่เรียบ	118
4.12	ผลการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์บนเครื่องประดับที่ผิวมีซอกมุม	118
4.13	เครื่องเคลือบค้นแบบที่ใช้ในการทดลองการเคลือบฟิล์มบาง	119
4.14	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์	
	ที่เคลือบบนกระจกสไลด์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	121
4.15	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์	
	ที่เคลือบบนกระจกสไลด์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	121
4.16	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์	
	ที่เคลือบบนกระจกสไลด์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	122
4.17	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มไททาเนียมไนไตรค์	
	จากการศึกษาของ Volvada	122
4.18	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์	
	ที่เคลือบบนแผ่นอะลูมิเนียม	122
4.19	รอยกดของเครื่อง Nano Indenter บนฟิล์มบาง	124
4.20	การทดสอบการยึดติดของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ที่อุณหภูมิวัสคุรองรับต่า	งกัน
	(a) ก่อนการทดสอบ	
	(b) หลังการทดสอบ	126
ก.1	แผนภาพของระบบสุญญากาศของเครื่องเคลือบ	139
ค.1	Power diffraction standard card for stoichiometric titanium nitride (TiN)	146
ค.2	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผงไททาเนียมไนไตรค์	147
ค 3	้ ราบบบการเกี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มไททาเนียมในไตรด์	147

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของการวิจัย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องประดับจัดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกสำคัญอย่างหนึ่งของ ประเทศไทยซึ่งต้องใช้การชุบเคลือบผิวเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผลิต และเมื่อพิจารณาในแง่ของ สิ่งแวคล้อมพบว่าการชบเคลือบที่ทำอย่ในปัจจบัน ส่วนใหญ่จะใช้วิชีชบเคลือบด้วยไฟฟ้า (electroplating) ซึ่งต้องใช้สารละลายเคมีในกระบวนการและมักจะมีสารละลายเคมีเหลือใช้จำนวน มากที่ยากต่อการกำจัดอีกทั้งยังก่อให้เกิดปัณหามลพิษต่อสิ่งแวคล้อมด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าสิ่งเหล่านี้ ้เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมประเภทนี้ นอกจากนี้สำหรับประเด็นปัณหาสิ่งแวคล้อมซึ่ง กำลังได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ ทำให้มีการกำหนดมาตรการป้อง กันในหลายรูปแบบ เช่น การกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวคล้อมโดยตรงเช่น ISO14000 นอกจากนี้บางประเทศในทวีปยุโรปมีการสั่งห้ามนำเข้าเครื่องประดับที่มีนิเกิล (nikel) เป็น ้ชั้นรองพื้น (ซึ่งก็คือการชุบเคถือบด้วยไฟฟ้านั่นเอง) จะเห็นได้ว่ามาตรการเหล่านี้ล้วนแต่มีผลกระทบ โดยตรงต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับในประเทศไทยทั้งสิ้น ทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชุบ เคลือบในประเทศไทยจำเป็นต้องหาวิธีการชบเคลือบใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ สำหรับในต่าง ประเทศได้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจน ประสบความสำเร็จและสามารถนำมาใช้จริงเชิงอุตสาหกรรมแล้วคือ "การเคลือบในสุญญากาศ" ้ เนื่องจากการเคลือบด้วยวิธีนี้จะทำภายในภาชนะสฌญากาศเท่านั้นจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ชั้นเคลือบ (หรือที่เรียกว่าฟิล์มบาง) ที่ได้ยังมีคณภาพสงกว่าการชบเคลือบด้วยไฟฟ้าอีกด้วย ดังนั้นการเคลือบในสญญากาศจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับอตสาหกรรมเครื่องประดับซึ่งจะสามารถ แก้ไขปัณหาต่างๆ ของการชบเคลือบด้วยไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของอุตสาหกรรมการเคลือบผิววัสดุในประเทศไทยนั้นพบว่ามีมาตั้งแต่สมัยหลัง สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยขนาดของกิจการมีตั้งแต่อุตสาหกรรมในครัวเรือนไปจนถึงอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ขนาดการลงทุนตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้านบาท โดยเทคโนโลยีที่ใช้กันแพร่หลายภาย ในประเทศตั้งแต่คั้งเดิมจนถึงปัจจุบันคือการชุบเคถือบในสารละลายด้วยไฟฟ้า จากการสำรวจเกี่ยว กับ อุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวโลหะและพลาสติก ของกองแผนงานและพัฒนา สำนักงานคณะ กรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปี พ.ศ.2538¹¹¹ พบว่าช่วงที่ผ่านมาเทคโนโลยีการชุบเคลือบในประเทศ ใทยมีการพัฒนาขึ้นมาก เนื่องจากการลงทุนของต่างประเทศซึ่งได้นำเทคนิคการชุบเคลือบใหม่ๆ เช่น ระบบการเคลือบในสุญญากาศ เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมเคลือบเลนส์ แว่นตา เลนส์กล้องถ่ายรูป กระจก บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น และจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยทั่ว ไป เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องจักรกล อุปกรณ์การก่อสร้าง และการส่งออกสิน ค้า เช่น ของเด็กเล่น อัญมณี ทำให้โรงงานรับจ้างชุบเคลือบตื่นตัวลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ราคาสูงขึ้น เช่น เริ่มนำเทคโนโลยีสุญญากาศมาใช้ แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักเนื่องจากเครื่องจักร ใหม่ส่วนใหญ่มีราคาแพง และเทคนิคการเคลือบในระบบสุญญากาศเป็นเรื่องใหม่สำหรับอุตสาห กรรมในประเทศ และที่สำคัญยังขาดแคลนบุคลากรและผู้มีความเชื่อวชาญในเทคโนโลยีสุญญากาศ และการเคลื่อบในสพพากาศ

นอกจากนี้ในรายงานฉบับคังกล่าว [1] ยังได้อธิบายความเป็นไปได้ที่ระบบการเคลือบใน ้สุญญากาศนั้นจะเข้ามาแทนที่ระบบการเคลือบเดิมเนื่องจากอุตสาหกรรมชุบเคลือบเดิมนั้นจะสัมพันธ์ กับปัญหาสิ่งแวคล้อมอย่างมาก เนื่องจากของเสียจากกระบวนการชุบเคลือบที่ใช้กันในปัจจุบันส่วน ใหญ่มีอันตรายสูงและมีปริมาณมากทำให้มีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีการเคลือบที่ ก่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุดมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าในอนาคตอาจจะมีการนำระบบการเคลือบใน สุญญากาสมาใช้แทนระบบการเคลือบเดิมเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่มากขึ้นด้วย ซึ่งจะนำ ไปสู่การพัฒนาการเคลือบขั้นสูงต่อไป ตลอดจนเป็นที่ต้องการของการพัฒนาอุตสาหกรรมใน ประเทศได้แก่ การเคลือบฟิล์มบางชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การเคลือบฟิล์มบางบนถุงพลาสติก การเคลือบกระจกเลเซอร์ การเคลือบกระจกที่ใช้เป็นส่วนประกอบของโคมไฟในทางการแพทย์ รวม ถึงการเคลือบชิ้นส่วนอากาศยานเป็นต้น ซึ่งในรายงานฉบับดังกล่าวยังได้เสนอแนะให้มีการเร่งพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับการเคลือบในสุญญากาศเพื่อรองรับความต้องการและการพัฒนาของประเทศใน อนาคตต่อไป

ในส่วนของชั้นเคลือบที่ได้จากการเคลือบในระบบสุญญากาศนั้นจะบางมาก (อยู่ในระดับ ใมครอน) จึงเรียกชั้นเคลือบที่ได้นี้ว่า ฟิล์มบาง (thin film) ซึ่ง Bunshah (1994) ได้ให้ความหมายของ ฟิล์มบางว่า "ฟิล์มบาง หมายถึง ชั้นของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมที่จับรวมกันเป็นชั้นบางๆ" ทั้งนี้ การที่จะระบุว่าฟิล์มใคเป็น "ฟิล์มบาง" อาจพิจารณาจากลักษณะการใช้งานว่าใช้สมบัติด้านใคของ ฟิล์มนั้น กล่าวคือถ้าเป็นการใช้ สมบัติเชิงผิว (surface properties) จะเรียกฟิล์มนั้นว่า "ฟิล์มบาง" แต่ ถ้าเป็นการใช้ สมบัติเชิงปริมาตร (bulk properties) จะเรียกฟิล์มนั้นว่า "ฟิล์มหนา" จะเห็นว่าฟิล์มเดียว กันนั้นอาจเป็น "ฟิล์มบาง" หรือ "ฟิล์มหนา" ก็ได้ขึ้นกับลักษณะการใช้เป็นสำคัญ อย่างไรก็ดีการ เคลือบฟิล์มบางนั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงสมบัติของวัสคุที่เคลือบให้ดีขึ้น เช่น ให้มีความคงทน ถาวร หรือสวยงามมากขึ้น ฯลฯ โดยการเคลือบฟิล์มบางจะเป็นกระบวนการทำ ให้สารเคลือบตกเคลือบบนผิวของวัสดุที่ต้องการ เริ่มจากการสร้างสารเคลือบในรูปของอะตอม โมเลกุลหรืออนุภาค จากนั้นเป็นการเคลื่อนย้ายสารเคลือบมายังวัสคุรองรับ เมื่อสารเคลือบตกกระทบ บนผิววัสคุรองรับก็เกิดการควบแน่นและพอกพูนเป็นชั้นของฟิล์มบางบนวัสคุรองรับในที่สุด^[2]

การเคลือบในสุญญากาศสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ การเคลือบแบบ Chemical Vapor Deposition: CVD ซึ่งอาศัยการแตกตัวของสารเคมีในสภาพแก๊สและเกิดปฏิกิริยาเคมีเป็นสารใหม่ตก เคลือบบนวัสคุรองรับ เช่น วิธี plasma CVD และ วิธี laser CVD เป็นต้น และการเคลือบแบบ Physical Vapor Deposition : PVD ซึ่งอาศัยการทำให้อะตอมของสารเคลือบหลดออกจากผิวแล้วฟัง กระจายเข้าจับและยึดติดกับผิวของวัสคุรองรับ เช่น วิธีระเทยสาร และ วิธีสปัตเตอริง เป็นต้น อย่างไร ก็ดีการเคลือบในสพพากาศที่น่าสนใจวิธีหนึ่งคือ การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริง เนื่องจากเป็น กระบวนเคลือบที่มีประสิทธิภาพและฟิล์มที่ได้ก็มีคณภาพดี การเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริงนี้เป็นจะเกิด ้ขึ้นภายใต้ความคันต่ำประมาณ 10^{-3} - 10^{-1} mbar โดยอาศัยการคิสชาร์จไฟฟ้าของแก๊สทำให้แตกตัวเป็น ใอออน จากนั้นใอออนเหล่านี้จะถูกเร่งให้วิ่งเข้าชนแผ่นเป้าสารเคลือบ (target) ซึ่งต่ออยู่กับขั้วลบของ แหล่งกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้อนุภาคของเป้าสารเคลือบที่ถูกชนด้วยไอออนของแก๊สจะหลุดออกมา และวิ่งค้วยความเร็วสูงเข้าชนและพอกพูน (deposition) เป็นชั้นของฟิล์มบางเคลือบบนวัสคุรองรับ (substrate) ในทุกทิศทาง และเนื่องจากพลังงานของอนภาคสารเคลือบจากกระบวนการสปัตเตอริงนี้ สูงมาก ดังนั้นเมื่อตกกระทบบนวัสดุรองรับก็จะมีการฝังตัวถงในเนื้อของวัสดุรองรับทำให้การยึด เกาะของฟิล์มที่ต้องการเคลือบดีมาก นอกจากนี้สารเคลือบ (เป้าสารเคลือบ) และวัสดุที่ต้องการเคลือบ (วัสดุรองรับ) ในระบบสปัตเตอริงอาจเป็นโลหะหรืออโลหะก็ได้ สำหรับวงการอุตสาหกรรมมีการนำ วิธีการเคลือบแบบสปัตเตอริงไปใช้ในกระบวนการผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือและวัสดุต่างๆ โดยฟิล์ม บางที่ใช้นั้นมีทั้งแบบชั้นเคียวหรือแบบหลายชั้น อาจเป็นฟิล์มของสารชนิคเคียว อัลลอยค์หรือสาร ประกอบ และอาจมีลักษณะหรือขนาดแตกต่างกันไป ส่วนสมบัติของฟิล์มบางแต่ละชนิดจะขึ้นอย่กับ ลักษณะการใช้งานเป็นสำคัญ^[3]

ปัจจุบันมีการนำฟิล์มบางมาประยุกต์ใช้ในงานหลายด้านเช่น [4]

- 1. การเคลือบฟิล์มบางสำหรับอุปกรณ์ทางแสง เช่น การเคลือบกระจกฉนวนกันความร้อน โดยเคลือบสารที่สะท้อนรังสึความร้อนเป็นชั้นบางๆ และเนื่องจากวัสคุนี้บางมากจึงยังคงยอมให้แสง ผ่านไปได้เช่น การเคลือบทองคำหรือไททาเนียมในไตรค์บางๆ บนแผ่นกระจก ทำให้มีสมบัติสะท้อน รังสีความร้อนได้ หรือการเคลือบกระจกเพื่อลดการสะท้อนที่ผิวเพื่อให้ปริมาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ ส่งผ่านมีค่าสูงสุด เช่น การเคลือบซิลิกอนมอนอกไซด์ลงบนผิวเคลือบบนเซลแสงอาทิตย์ เป็นต้น
- 2. การเคลือบฟิล์มบางสำหรับอุปกรณ์ทางไฟฟ้า เช่น การเคลือบฟิล์มตัวต้านทาน ได้แก่ ฟิล์มของนิเกิล โครเมียม แทนทาลัม หรือไททาเนียมในไตรค์ ซึ่งเป็นฟิล์มความต้านทานที่มีเสถียร ภาพสูง หรือการเคลือบฟิล์มตัวเก็บประจุ ได้แก่การเคลือบสาร ไดอิเล็กตริกของแทนทาลัมออกไซด์ หรือแบเรียมไททาเนตซึ่งมีค่าไคอิเล็กตริกสูง ทำให้ตัวเก็บประจุมีขนาดเล็กและราคาถูก หรือการ เคลือบฟิล์มแม่เหล็กซึ่งใช้ในอุปกรณ์บันทึกความจำ เช่น เทป หรือจานบันทึกข้อมูล หรือ การเคลือบ ผิวโฟโตคอนดักเตอร์ (photoconductor) เช่น วัสดุที่ใช้ตรวจวัดรังสีอินฟราเรดมักเคลือบผิวด้วยตะกั่ว ซัลไฟด์ ตะกั่วเซเลไนต์ ตะกั่วเทลลไรด์ เป็นต้น

- 3. การเคลือบฟิล์มบางสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น การเคลือบแข็งทนทานต่อการ สึกหรอ อุปกรณ์บางชิ้นของเครื่องจักรกลที่มีอัตราการสึกหรอสูงและใช้งานที่อุณหภูมิสูง เช่น ใบพัด ใบมีคกถึง คอกสว่าน เมื่อนำมาเคลือบด้วยวัสคุที่มีความแข็งและทนต่ออุณภูมิสูง เช่น โลหะในไตรด์ โลหะคาร์ไบต์ หรือเซอร์โคเนียมออกไซค์ ก็จะสามารถยืดอายุการใช้งานได้ เช่น ไททาเนียมไนไตรค์ มีสมบัติแข็ง ทนอุณหภูมิสูง และมีสัมประสิทธิ์การเสียดทานต่ำจึงเหมาะกับการเคลือบแบริ่ง มีคกลึง ดอกสว่าง เซอร์ โคเนียมออก ใชด์แข็งทนอุณหภูมิสูง ยึดเกาะกับเนื้อเหล็ก ได้ดีทุกช่วงอุณหภูมิ เป็นต้น
- 4. การเคลือบฟิล์มบางสำหรับอปกรณ์ทางเคมี เช่น การเคลือบผิวอปกรณ์ที่ใช้ในทะเล (marine equipment) การเคลือบผิวทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี (corrosion ressistance coatings) หรือ การเคลือบผิวด้วยสารตัวเร่งปฏิกิริยา (catalytic coatings) เป็นต้น
- 5. การเคลือบฟิล์มบางสำหรับเครื่องประดับ เช่น การเคลือบไททาเนียมในไตรด์ที่มีสีทอง หรือไททาเนียมคาร์ไบด์ที่มีสีเงินลงบนสายและตัวเรือนนาฬิกา กรอบแว่นตา คุ้มหู สร้อย ซึ่งให้ทั้ง ความสวยงามและผิวที่แข็งทนทานต่อการขีดข่วน เป็นต้น

ฟิล์มบางที่เคลือบในสุญญากาศมีหลายชนิด ซึ่งมีสมบัติแตกต่างกันไป แต่มีฟิล์มชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจมากทั้งในแง่ของการวิจัยและประยุกต์ใช้งาน คือ ฟิล์มบางของไททาเนียมใน ใตรค์ เนื่องจากไททาเนียมในไตรค์เป็นวัสคุเซรามิคที่มีสมบัติสำคัญหลายค้านเช่น มีความเสถียรทาง เคมีสูง ทนอุณหภูมิสูง มีความแข็งสูง มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิวสัมผัสต่ำ สามารถนำไฟฟ้า ได้และมีสีทอง ซึ่งสมบัติเหล่านี้เป็นที่น่าสนใจในการนำมาประยุกต์ใช้งานเชิงอุตสาหกรรม เช่น สมบัติด้านความแข็งอาจนำมาใช้เคลือบบนมีดกลึงและดอกสว่าน เพื่อลดการสึกหรอและอุณหภูมิ ของคอกสว่านทำให้สามารถยึดอายการใช้งานได้หลายเท่าตัว ที่สำคัญฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์มี สีทองสวยงามจึงอาจนำไปเคลือบบนเครื่องประดับ เช่น เข็มกลัด ต้มห สร้อย สายนาฬิกาและกรอบ แว่นตา ฯลฯ ซึ่งทำเครื่องประดับเหล่านั้นมีความสวยที่คงทนไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนง่าย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องประดับในประเทศส่วนใหญ่ใช้วิชีการชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า ซึ่ง มีข้อเสียด้านปัญหาสิ่งแวคล้อม ทำให้อุตสาหกรรมการชุบเคลือบเครื่องประดับในประเทศต้องหาวิธี การชุบเคลือบใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งนี้จะเห็นว่าการเคลือบในสุญญากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ เคลือบด้วยวิชีสปัตเตอริงนั้นเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นการเคลือบใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ที่จะช่วยแก้ใบปัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการเคลือบด้วยวิธีนี้เกิดขึ้นเฉพาะ ภายในภาชนะสุญญากาศเท่านั้นจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ชั้นเคลือบที่ได้ยังมีคุณ ภาพสูงกว่าวิชีการชุบเคลือบด้วยไฟฟ้าอีกด้วย ดังนั้นการเคลือบในสุญญากาศจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับซึ่งสามารถแก้ปัญหาข้างต้นได้เป็นอย่างดี และในส่วนของฟิล์ม บางที่น่าสนใจสำหรับนำมาเคลือบชิ้นงานประเภทเครื่องประดับคือ ฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ ซึ่ง สมบัติที่เหมาะสมหลายอย่าง เช่น มีสีทอง และมีความแข็งทนต่อการขีดข่วน จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่ จะนำมาเคลือบเครื่องประดับ

ปัจจุบันพบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยหลายแห่งได้นำเทคโนโลยี ้สุญญากาศเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลือบในสุญญากาศ แต่ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือสำเร็จรูปซึ่งมีราคาสูงมากเข้ามาทั้งหมดเพื่อเร่งการ ผลิตเป็นสำคัญ (จากการสอบถามตัวแทนจำหน่ายเครื่องเคลือบชนิคนี้พบว่าส่วนใหญ่จะมีราคาสง มาก เช่น เครื่องเคลือบในสญญากาศที่ใช้ในระดับวิจัยจะมีราคาทั้งระบบประมาณ 8 ถ้านบาทต่อชด ส่วนเครื่องเคลือบที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรมจะมีราคาทั้งระบบประมาณ 16 ล้านบาทต่อชุดขึ้นไป) แต่เมื่อพิจารณาความพร้อมของประเทศไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ กลับพบว่ายังอย่ในเกณฑ์ต่ำมาก เนื่องจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในประเทศไทยยังมีน้อย ดังนั้นเพื่อรองรับเทคโนโลยี นี้ในอนาคตจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาและเตรียมความพร้อมในทุกด้าน

คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีนี้ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนา ประเทศ จึงเริ่มศึกษาวิจัยและเตรียมความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีสุญญากาศและเทคโนโลยีฟิล์มบาง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 การคำเนินการในระยะแรก (ปึงบประมาณ 2536-2539) เป็นการเตรียมความ พร้อมด้านต่างๆ (บุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัย) ต่อมาคณะผู้วิจัยได้เริ่มทำการศึกษาวิจัยเพื่อ สร้างเครื่องเคลือบฟิล์มบางด้วยวิชีสปัตเตอริง ตลอดจนศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเคลือบ ฟิล์มบางด้วยเครื่องเคลือบที่สร้างขึ้นจนเป็นที่สำเร็จ (งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2540-2541) และจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทำให้คณะผู้วิจัยสามารถพัฒนาหน่วยวิจัยที่ดำเนินการมาเป็น "ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง" (ในปี พ.ศ.2541)

จากเหตุผลข้างต้นประกอบกับความพร้อมของคณะผู้วิจัยทุกด้าน ทั้งด้านบุคลากร อปกรณ์ เครื่องมือวิจัย ตลอคจนประสบการณ์ค้านเทคโนโลยีสฌญากาศและฟิล์มบาง ทำให้คณะผ้ วิจัยสนใจที่จะทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้เพื่อประยกต์ในอตสาหกรรมเครื่องประดับ โดยมั่น ใจว่าสามารถนำผลการวิจัยที่ได้ศึกษามาพัฒนาต่อเพื่อใช้จริงเชิงอุตสาหกรรม จึงขอเสนอโครงการ "การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ด้วยวิธีสปัตเตอริง สำหรับอุตสาหกรรม เครื่องประดับ" เพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฝ่าย 5) ซึ่งได้รับการ อนุมัติให้คำเนินโครงการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2542 โดยมีบริษัท บางกอก แอสเสย์ ออฟฟิส จำกัด เป็นผู้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัย สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องเคลือบฟิล์มบาง ระบบสปัตเตอริงสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทนาเนียมในไตรค์บนเครื่องประดับ ศึกษาเทคนิคและ กระบวนการเคลือบฟิล์มบาง ตลอดจนศึกษาสมบัติของฟิล์มบางที่เคลือบบนเครื่องประดับเพื่อ ประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือ เหล่านี้จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เป็นจดเริ่มของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี แบบพึ่งตนเองซึ่งทำให้เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีในที่สด

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องเคลือบฟิล์มบางด้วยระบบสปัตเตอริงสำหรับ เคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์บนเครื่องประดับ
- 2. เพื่อศึกษาเทคนิคและกระบวนการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์บนเครื่อง ประดับ
 - 3. เพื่อศึกษาสมบัติของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ที่เคลือบบนเครื่องประดับ

1.3 แนวทางและวิธีดำเนินงานโดยย่อ

โครงการวิจัยและพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องเคลือบฟิล์มบาง ระบบสปัตเตอริงสำหรับเคลือบฟิล์มบางไทนาเนียมในไตรด์บนเครื่องประดับ เพื่อศึกษาเทคนิคและ กระบวนการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์ เพื่อศึกษาสมบัติของฟิล์มบางที่เคลือบบนเครื่อง ประดับ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดการนำเข้าอุปกรณ์ และเครื่องมือเหล่านี้จากต่างประเทศแล้วยังเป็นจดเริ่มของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแบบพึ่งตน เองซึ่งจะทำให้เราเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเองในที่สุด และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักของโครง การ คณะผู้วิจัยได้แบ่งวิชีดำเนินงานเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ (1) การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่อง เคลือบฟิล์มบางแบบสปัตเตอริง (2) การศึกษาเทคนิคและกระบวนการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมใน ใตรค์ และ (3) การศึกษาสมบัติของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์ที่ได้ มีแนวทางการคำเนินงานโคย ย่อดังนี้

- 1. การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องเคลือบฟิล์มบางแบบสปัตเตอริง ขั้นนี้จะเป็นการ ออกแบบระบบของเครื่องเคลือบ ซึ่งประกอบด้วย ระบบสณณากาศ ระบบเคลือบ และระบบควบคม เพื่อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาประกอบเป็นเครื่องเคลือบ โดยเน้นการออกแบบและสร้างขึ้น ด้วยวัสคที่มีในประเทศ ขั้นตอนนี้แบ่งเป็น
- 1.1 การสร้างต้นแบบเครื่องเคลือบตามที่ได้กำหนดไว้ ประกอบด้วยระบบสุญญากาศ ระบบเคลือบ และระบบควบคม
 - 1.2 การทดสอบระบบสุญญากาศของเครื่อง เพื่อหาความดันต่ำสุดของเครื่องเคถือบ
 - 1.3 การทคสอบการเคลือบฟิล์มบาง เพื่อทคสอบว่าเครื่องเคลือบทำงานได้หรือไม่
- 1.4 การทดสอบแมกนีตรอน คาโทดของเครื่องเคลือบ เพื่อหาข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ความ สัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์ของคาโทค การทคสอบหาระยะที่มีการกระจายตัวของสาร เคลือบดีที่สด การทดสอบการกระจายตัวของสารเคลือบ
 - 1.5 การหาอัตราเคลือบของเครื่องเคลือบ

- 2. การศึกษาการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์นำร่อง เนื่องจากความยุ่งยากในการ เคลือบด้วยวิธีรีแอคทีฟ สปัตเตอริง เพื่อให้ได้ฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ที่มีสีทอง คณะผัวิจัยจึงได้ ศึกษานำร่องบนเครื่องเคลือบระดับวิจัย (ขนาดเล็ก) เพื่อทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ต่างๆ ที่จะเกิด ้ขึ้น ก่อนที่จะทำการทดลองจริงบนเครื่องต้นแบบที่สร้างขึ้นในโครงการนี้ ขั้นตอนนี้แบ่งเป็น
 - 2.1 การศึกษาการเตรียมฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์
- 2.2 การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราไหลของแก๊สในโตรเจนต่อสีของฟิล์มบาง ใททาเนียมในไตรด์
 - 2.3 การทดลองเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์บนวัสดรองรับชนิดต่างๆ
- 3. การศึกษาการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ด้วยเครื่องต้นแบบ จากการศึกษาถึง เทคนิค ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์จากการศึกษา นำร่อง ทำให้คณะผู้วิจัยเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเงื่อนไขและความสัมพันธ์ของตัว แปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการทคลองคัวยเครื่องเคลือบต้นแบบที่สร้างขึ้น โคย ขั้นตอนนี้จะแบ่งเป็น
 - 3.1 การศึกษาการเตรียมฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์
 - 3.2 การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราใหลของแก๊สในโตรเจนต่อสีของฟิล์มบาง ไททาเนียมในไตรด์
 - 3.3 การทดลองเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์บนวัสดุรองรับชนิดต่างๆ
 - 3.4 การทดลองเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์บนเครื่องประดับ
- 4. การศึกษาสมบัติของฟิล์มบางไททาเนียมในไตรด์ ในส่วนนี้จะเป็นการทดสอบฟิล์ม บางที่เคลือบได้ด้วยเทคนิค XRD เพื่อยืนยันว่าฟิล์มที่ได้เป็นฟิล์มของไททาเนียมในไตรด์ วัดความ แข็งของฟิล์มด้วยเทคนิค Nano-Indenter รวมถึงทดสอบการยึดติดของฟิล์ม

1.4 ขอบเขตของโครงการ

- 1. ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องเคลือบฟิล์มไททาเนียมในไตรด์ แบบดีซี แมกนิตอน สปัตเตอริง ที่สามารถเคลือบฟิล์มบางบนวัสดุที่มีพื้นผิวเรียบได้
 - 2. เครื่องเคลือบที่สร้างขึ้นสามารถเคลือบชิ้นงานได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น
- 3. เครื่องเคลือบที่สร้างขึ้นสามารถเคลือบเครื่องประดับที่ทำจากวัสดุต่างๆ ได้ เช่น เข็ม กลัด หัวเข็มขัด ต่างห พวงกณแจ
- 4. เครื่องเคลือบที่สร้างขึ้นสามารถทำความดันได้อย่ในช่วงประมาณ $10^{-6}\,\mathrm{mbar}$ และ สามารถเคลือบได้ที่ความดันในช่วงประมาณ 10⁻³ mbar ได้
- 5. เครื่องเคลือบที่สร้างขึ้นในโครงการนี้จะเน้นการใช้วัสคุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ใน ประเทศเป็นหลัก

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

- 1. ได้ต้นแบบเครื่องเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์ด้วยวิชีสปัตเตอริง สำหรับเคลือบ เครื่องประดับ ซึ่งคณะผู้วิจัยเชื่อว่าผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ จริงเชิงอุตสาหกรรมได้ เนื่องผลของการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคณะผู้วิจัยเกี่ยวกับ เทคโนโลยีนี้
- 2. ทำให้ทราบ know how ของการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมในไตรค์ ด้วยวิธีสปัตเตอริง บนเครื่องประดับด้วยตนเองอันเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศแบบพึ่งตนเอง
- 3. เป็นการทดแทนการนำเข้าเครื่องมือ อปกรณ์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเคลือบใน สญญากาศจากต่างประเทศ
- 4. เป็นการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้เรียนรู้เทคโนโลยีการเคลือบใหม่ ซึ่งจะทำให้ ้เกิดการถ่ายทอดความรู้และขยายวงในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีการเคลือบใน สุญญากาศสู่อุตสาหกรรมภายในประเทศ
- 5. เนื่องจากการเคลือบฟิล์มบางค้วยวิชีสปัตเตอริงนี้เป็นการเคลือบในสุญญากาศ ซึ่งเกิด ้ขึ้นจำกัดภายในภาชนะสุญญากาศเท่านั้น ดังนั้นด้วยวิชีนี้จึงไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดถ้อมทั้งด้าน น้ำและอากาศ ซึ่งเหมาะสมที่จะนำเข้ามาแทนที่การชุบเคลือบด้วยไฟฟ้า (electroplating) ได้
- 6. ผลพลอยใค้อย่างหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาโครงการนี้คือ know how ต่างๆ เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสุญญากาส เนื่องจากการศึกษาในโครงการนี้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีสุญญากาศเป็น พื้นฐานในการคำเนินงาน

บทที่ 2

ทฤษฎี

บทนี้กล่าวถึงทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในโครงการนี้ซึ่งแบ่งเป็น 8 ส่วน (1) ระบบสองจากาศ (2) เทคโนโลยีฟิล์มบาง (3) การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริง (4) อปกรณ์ ในระบบ ดี ซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง (5) ลักษณะเฉพาะตัวของระบบสปัตเตอริง (6) การเคลื่อบ แบบรีแอคทีฟ สปัตเตอริง (7) สมบัติ โครงสร้างและการใช้งานของไททาเนียมในไตรค์ และ (8) การ หาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบาง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.1 <u>ระบบสุญญากาศ [5][6]</u>

"สุญญากาศ" หรือ "vacuum" เป็นคำในภาษากรีก หมายถึง "ที่ว่าง" ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว ถ้ามีภาชนะปิดอันหนึ่งแล้วสูบ อากาศ แก๊ส และไอของสารต่างๆ ในภาชนะนั้นออกก็จะเรียกสภาวะ ในภาชนะหลังการสูบว่า "สุญญากาศ" ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าความเป็นสุญญากาศของภาชนะหนึ่งๆ นั้น จะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นกับการสูบอากาศออกจากภาชนะนั้นว่าได้มากน้อยเพียงใด หากสูบอากาศ ออกจากภาชนะ ได้มากความเป็นสุญญากาศของภาชนะนั้นก็มีมาก แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีระบบ ใดหรือภาชนะใดที่เป็นสญญากาศได้อย่างสมบรณ์ เพราะไม่มีเครื่องมือใดสามารถสบอากาศ แก๊ส และ ใอชนิดอื่นๆ ออกจากระบบหรือภาชนะ ได้หมด

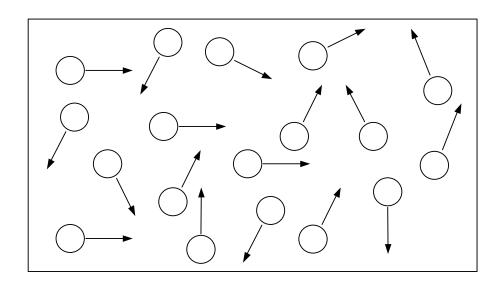
2.1.1 ธรรมชาติของสณณากาศ

"แก๊ส" ในสญญากาศจะหมายถึง แก๊สที่ไม่กลั่นตัว (noncondensable gases) และ ไอ (vapors) ทุกชนิด โดย "แก๊สที่ไม่กลั่นตัว" หมายถึง แก๊สที่ไม่สามารถที่จะกลั่นตัวเป็นของเหลวหรือ อัดตัวเป็นของแข็งได้ภายใต้สภาวะปกติ เช่น อากาศแห้งและ ไอน้ำก็เป็นตัวอย่างที่ดีของไอที่มีอยู่ใน อากาศโดยทั่วไป ทั้งนี้โดยปกติแล้วอากาศจะประกอบด้วยแก๊สหลายชนิดแต่จะมีแก๊สในโตรเจนและ แก๊สออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสำคัญ (ตารางที่ 2.1) ทั้งนี้สำหรับแก๊สที่บรรจุอยู่ในภาชนะปิดนั้นจะ ้มีความดันอยู่ค่าหนึ่งเสมอ โดยความดันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากโมเลกุลเล็กๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ แก๊สนั้นจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วในทกทิศทกทาง และอาจจะชนกันเอง หรือชนกับผนังของภาชนะ แล้วสะท้อนกลับออกมา การชนผนังภาชนะของโมเลกุลของแก๊สเหล่านี้เองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด ความดับขึ้นที่ผนังภาชนะนั้น

ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบของอากาศที่ระดับน้ำทะเล $^{\scriptscriptstyle{[7]}}$

ชนิดของแก๊ส	ปริมาตร (ร้อยละ)
ในโตรเจน	78.08
ออกซิเจน	20.95
อาร์กอน	0.93
คาร์บอนไดออกไซด์	0.03
นื้ออน	0.0018
ฮีเลียม	0.0005
มีเทน	0.0002
คริพตอน	0.0001
ใฮโครเจน	0.00005

ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของโมเลกุลแก๊สในภาชนะปิด แสดงได้ดังรูปที่ 2.1 ซึ่งแต่ละ โมเลกุลอาจจะมีอัตราเร็วต่างกันไป อย่างไรก็ดีสามารถพิจารณาได้ว่าโมเลกุลเหล่านี้เคลื่อนที่ด้วย อัตราเร็วเท่ากันเรียกอัตราเร็วนี้ว่า "อัตราเร็วเฉลี่ย" นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยแล้วก็ยังถือได้ว่า จำนวนโมเลกุลที่เคลื่อนที่ในแต่ละทิศทางเท่ากันอีกด้วย และเมื่อแก๊สในภาชนะได้รับความร้อนจาก ภายนอกอัตราเร็วเฉลี่ยนี้จะมีค่าสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอากาศ แก๊ส หรือไอของชาตุใดก็ตาม ระยะระหว่างโมเลกุลจะมีค่ามากกว่าเส้นผ่าสูนย์กลางของโมเลกุลมากๆ และถ้ามีการสูบเอาแก๊สนั้นออกไปจาก ภาชนะปิดระยะระหว่างโมเลกุลนี้ก็จะมีค่ามากขึ้น



รูปที่ 2.1 การเคลื่อนที่ของโมเลกุลแก๊สในภาชนะปิด $^{[8]}$

เนื่องจากโมเลกุลของแก๊สจะวิ่งด้วยอัตราเร็วสูงในทิศทางต่างๆ กัน ซึ่งนอกจากจะ ทำให้โมเลกุลชนกันเองแล้ว ยังทำให้โมเลกุลเหล่านี้ชนผนังภาชนะด้วย เมื่อโมเลกุลชนผนังภาชนะ จะสะท้อนกลับ โมเลกุลแก๊สจะถ่ายเทโมเมนตัมให้แก่ผนังทำให้เกิดแรงกระทำต่อผนังภาชนะ แรงที่โมเลกุลแก๊สกระทำต่อพื้นที่ 1 ตารางหน่วย คือ ความดัน (pressure) ของแก๊สในภาชนะนั่นเอง ซึ่ง ความดันนี้เป็นปริมาณที่สำคัญมากในทางสุญญากาส เมื่อมีการสูบเอาแก๊สออกจากภาชนะความดันก็จะลดลง เพราะจำนวนโมเลกุลที่ชนผนังภาชนะในหนึ่งหน่วยเวลาลดลง เมื่อมีการให้ความร้อนแก่ แก๊สอุณหภูมิของแก๊สก็จะสูงขึ้น อันมีผลทำให้อัตราเร็วของโมเลกุลภายในมากขึ้นไปด้วยจำนวนครั้งที่โมเลกุลชนผนังภาชนะในหนึ่งหน่วยเวลาจึงเพิ่มขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ความดันของแก๊สเพิ่มขึ้น

2.1.2 หน่วยวัดความดัน

หน่วยของความดัน เป็น หน่วยของ "แรง/พื้นที่" ในระบบ SI คือ N/m² หรือ Pa มี การกำหนดค่าความดันของอากาสที่ระดับน้ำทะเลเมื่ออุณหภูมิ 0 °C เท่ากับ ความดัน 1 บรรยากาส ซึ่ง ความดันนี้มีค่าประมาณ 105 N/m² ซึ่งความดันขนาดนี้สามารถดันปรอทให้ขึ้นไปตามท่อสุญญากาส ได้สูง 760 mm และจากการที่ความดันอากาสสามารถดันให้ปรอทขึ้นไปตามท่อสุญญากาสได้นี้เองจึง มีการประยุกต์ปรากฎการณ์นี้มาใช้เป็นหน่วยวัดความดันอีกหน่วยหนึ่ง โดยให้ความดัน 1 บรรยากาส หรือ 105 N/m² มีค่าเท่ากับ 760 mm Hg

นอกจากหน่วยวัดดังกล่าวแล้วยังมีการใช้หน่วยอื่นๆ ในการวัดความดันอีก เช่น

หน่วย ทอรร์ (torr) โดย 1 torr เท่ากับ 1 mm Hg

หน่วย บาร์ (bar) โดย 1 bar เท่ากับ 750.06 mm Hg

หน่วย ใมครอน (micron) โดย 1 μ เท่ากับ 10^{-3} torr

ในทางเทคนิคเกี่ยวกับสุญญากาสมักใช้หน่วย mm Hg หรือ torr หรือ bar ในการวัด ความดัน มากกว่าหน่วย N/m² สำหรับปริมาณที่แสดงว่าระบบปิดหนึ่งๆ นั้นมีความเป็นสุญญากาส มากน้อยเพียงใดนั้นสามารถบอกได้ด้วยองสาแห่งสุญญากาส ซึ่งสามารถจำแนกได้โดยการใช้ความ ดันภายในระบบนั้นๆ เป็นเกณฑ์

ตารางที่ 2.2 การจำแนกองศาแห่งสุญญากาศ ตามความคันภายในระบบ $^{[9]}$

องศาแห่งสุญญากาศ	ความดันภายในระบบ (mm Hg)
ต่ำ (low vacuum)	760 - 25
ปานกลาง (medium vacuum)	25 - 10 ⁻³
ក្លុଏ (high vacuum)	10 ⁻³ - 10 ⁻⁶
สูงมาก (very high vacuum)	10 ⁻⁶ - 10 ⁻⁹
สูงอย่างมาก (ultra high vacuum)	10 ⁻⁹ และน้อยกว่า

2.1.3 ระยะปลอดการชน (Mean Free Path)

โมเลกุลแก๊สในภาชนะมีการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วสูงและอาจชนกันเองก่อนที่จะ ชนผนังภาชนะ ถ้าพิจารณาโมเลกุลเฉพาะตัวโมเลกุลหนึ่งให้เป็นโมเลกุล A ระยะทางที่โมเลกุล A เคลื่อนที่ได้หลังการชนกับโมเลกุลอื่นแต่ละครั้งจะไม่เท่ากัน และเมื่อพิจารณาโมเลกุล B อีกตัวหนึ่งก็ จะพบว่าระยะระหว่างการชนของ B ไม่เท่ากับของ A อย่างไรก็ดีสามารถหาค่าเฉลี่ยของระยะระหว่าง การชนของแต่ละโมเลกุลของแก๊สได้ เรียกระยะเฉลี่ยนี้ว่า "ระยะปลอดการชน"

ค่าของระยะปลอดการชนขึ้นกับความคัน กล่าวคือแก๊สที่มีความคันมากจะมีระยะปลอดการชนสั้น เพราะที่อุณหภูมิหนึ่งๆ แก๊สที่มีความคันมากจะมีความหนาแน่นของโมเลกุลสูงกว่า แก๊สที่มีความคันต่ำ สำหรับระบบปิดอันหนึ่งๆ ถ้าความคันของแก๊สในระบบนั้นค่ำพอโมเลกุลของ แก๊สก็จะสามารถเคลื่อนที่จากผนังด้านหนึ่งของภาชนะไปยังอีกด้านหนึ่งได้โดยไม่มีการชนกับ โมเลกุลอื่น เรียกความคันในสภาวะนี้ว่า ช่วงความคันของโมเลกุลอิสระ (free molecule pressure region) ซึ่งในสภาวะนี้ระยะปลอดการชนจะมีค่ายาวมากเมื่อเทียบกับขนาดของภาชนะที่ใส่แก๊ส ใน ทางกลับกันก็มีช่วงของความคันที่ระยะปลอดการชนจะมีค่าน้อยกว่าขนาดของภาชนะมาก กรณีเช่นนี้ เมื่อโมเลกุลหนึ่งเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งของภาชนะไปยังอีกด้านหนึ่งโมเลกุลนั้นจะชนกับโมเลกุลอื่น หลายครั้ง หากแก๊สในสภาวะนี้กำลังใหลอยู่ในท่อ การใหลจะมีลักษณะเหมือนการใหลของของเหลว ที่มีความหนืดสูงจึงเรียกความคันในช่วงที่มีระยะปลอดการชนสั้นๆ นี้ว่า ช่วงหนืด (viscous region) อย่างไรก็ดีค่าของระยะปลอดการชนของแก๊สแต่ละชนิดไม่เท่ากัน โดยแก๊สที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่จะ มีระยะปลอดการชนน้อยกว่าแก๊สที่มีโมเลกุลเล็กกว่า

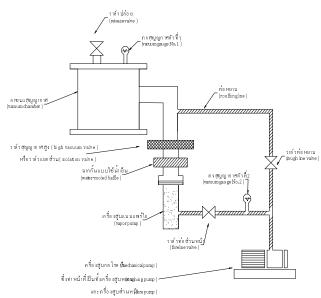
2.1.4 ส่วนประกอบของระบบสุญญากาศ

ระบบสุญญากาศอาจมีลักษณะเฉพาะตัวแตกกัน ขึ้นกับการออกแบบเพื่อให้สอด คล้องกับการใช้งาน แต่โดยพื้นฐานแล้วระบบสุญญากาศจะมีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนคือ ภาชนะ สุญญากาศ ระบบเครื่องสูบสุญญากาศ ระบบท่อเชื่อมต่อและอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น วาล์ว (valve) ที่ดัก ใอ (trap) ฯลฯ ความจำเป็นและความต้องการอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นกับการออกแบบและการใช้งาน

ตัวของระบบสุญญากาสพิจารณาได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ คือ ถ้าต้องการให้ภาชนะ สุญญากาสมีความดันในช่วง 10⁻³-10⁻¹ mbar ทำได้โดยต่อภาชนะสุญญากาสเข้ากับเครื่องสูบกลโรตารี (rotary mechanical pump) ก็เพียงพอ แต่ถ้าต้องการให้มีความดันต่ำขนาด 10⁻⁷-10⁻⁵ mbar ก็จำเป็นต้อง ใช้เครื่องสูบแบบแพร่ไอ (vapor pump) ร่วมกับเครื่องสูบกลโรตารี ดังแสดงในรูปที่ 2.2 ที่แสดงผัง การทำงานของระบบสุญญากาสที่ให้ความดันต่ำกว่า 10⁻⁵ mbar ท่อหยาบ (roughing line) ในระบบ เป็นท่อที่ต่อเชื่อมระหว่างภาชนะสุญญากาสกับเครื่องสูบกลโดยตรง โดยก่อนที่จะใช้เครื่องสูบแบบ เพร่ไอต้องใช้เครื่องสูบกลจนความดันภายในภาชนะมีค่าประมาณ 10⁻³ mbar ก่อน ด้วยเหตุนี้จึงเรียก เครื่องสูบกลในระบบนี้ว่า เครื่องสูบหยาบ (roughing pump)

ขณะที่เครื่องสูบกลโรตารีทำงานต้องเปิดวาล์วท่อหยาบ (roughing line valve)

พร้อมกับปิดวาล์วท่อส่วนหน้า (foreline valve) จนความคันในภาชนะสุญญากาสมีค่า 10⁻² - 10⁻³ mbar ก่อนแล้วจึงทำการสูบอากาสที่เหลือด้วยเครื่องสูบแบบแพร่ ใอ โดยขณะนี้จะต้องปิดวาล์วท่อหยาบ พร้อมกับเปิดวาล์วท่อส่วนหน้าและ วาล์วสุญญากาสสูง (high vacuum valve) ซึ่งวาล์วตัวหลังนี้ สามารถแยกภาชนะสุญญากาสออกจากส่วนที่เหลือของระบบ บางครั้งเรียกวาล์วนี้ว่า วาล์วแยกส่วน (isolation valve) อากาสที่เครื่องสูบแบบแพร่ ใอสูบออกจากภาชนะจะไปรวมกันอยู่ที่ส่วนถ่างของ เครื่องสูบแบบแพร่ ใอจากนั้นเครื่องสูบกลโรตารีจะสูบอากาสส่วนนี้ออกสู่ภายนอกอีกต่อหนึ่ง และ เรียกเครื่องสูบกลโรตารีที่ทำหน้าที่นี้ว่า เครื่องสูบส่วนหน้า (fore pump) เรียกท่อที่เชื่อมต่อระหว่าง เครื่องสูบแบบแพร่ ใอกับเครื่องสูบส่วนหน้าว่า ก่อส่วนหน้า (fore line) เรียกวาล์วปิด-เปิดท่อส่วน หน้าว่า วาล์วท่อส่วนหน้า ระบบสุญญากาสบางระบบจะแยกเครื่องสูบกลโรตารีที่ทำหน้าที่เป็นเครื่อง สูบส่วนหน้าและเครื่องสูบหยาบออกจากกัน แต่บางระบบก็ใช้เครื่องสูบเพียงตัวเดียวในการทำหน้าที่ ทั้งสอง ระบบในรูปที่ 2.2 เป็นระบบที่ใช้เครื่องสูบกลโรตารีเพียงตัวเดียว วาล์วปล่อย (release valve) ในที่รูป 2.2 ทำหน้าที่ปล่อยอากาสเข้าสู่ภาชนะทำให้ความคันภายในภาชนะไม่เป็นสุญญากาส บรรยากาส โดยจะเปิดวาล์วปล่อยนี้เมื่อ ใม่ต้องการให้สภาพภายในภาชนะไม่เป็นสุญญากาส



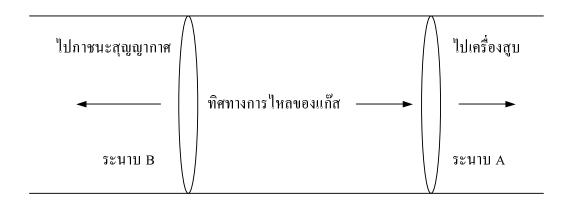
รูปที่ 2.2 ผังการทำงานของระบบสุญญากาศที่มีความคัน 10^{-3} - $10^{-7}~\mathrm{mbar}^{[10]}$

สำหรับเครื่องมือวัดความคันภายในภาชนะสุญญากาศเรียกว่าเกงสุญญากาศ (vacuum gauge) ซึ่งระบบสุญญากาศในรูปที่ 2.2 ประกอบด้วยเครื่องวัดนี้ 2 ตัว คือ เกงสุญญากาศตัว ที่หนึ่งต้องมีความสามารถวัดความคันต่ำได้ เพราะเครื่องวัดนี้ต้องวัดความคันภายในภาชนะ สุญญากาศซึ่งมีค่าประมาณ 10⁻⁶ mbar ส่วนเกงตัวที่สองจะทำหน้าที่วัดความคันในท่อส่วนหน้าซึ่ง เป็นบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องสูบแบบแพร่ไอกับเครื่องสูบกลโรตารี

2.1.5 ปริมาณของแก๊สและแรงขับ

ปริมาณของแก๊ส (quantity of gas) เป็นผลคูณระหว่างความคันกับปริมาตรของ แก๊สที่ปรากฏที่อุณหภูมิเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบนิยามของปริมาณแก๊สนี้กับกฎแก๊สจะเห็นได้ว่าค่า ของปริมาณแก๊สนี้แปรผันโดยตรงกับจำนวนโมเลกุลของแก๊ส

นอกจากปริมาณของแก๊สแล้วยังมีการกำหนดปริมาณที่เรียกว่า แรงขับ (throughput) ขึ้น เพื่อใช้ในการวัดอัตราการใหลของแก๊สโดยกำหนดว่า ที่อุณหภูมิหนึ่งๆ แรงขับ ก็คือ ปริมาณของแก๊สที่ใหลผ่านพื้นที่หน้าตัดของส่วนของระบบสุญญากาศในหนึ่งหน่วยเวลา



รูปที่ 2.3 การใหลของแก๊สในระบบสุญญากาศ [11]

ในรูปที่ 2.3 แก๊สจะใหลจากซ้ายไปขวาได้ ความดันทางซ้ายจะต้องมากกว่าความ ดันทางขวา ถ้าสามารถวัดปริมาณแก๊สที่ผ่านระนาบ A ได้โดยตรงว่ามีค่าเท่าใดในช่วงเวลาหนึ่งๆ ก็ สามารถจะคำนวณค่าแรงขับได้ โดยนำจำนวนของแก๊สนั้นหารด้วยช่วงเวลาที่ใช้ แต่ในทางปฏิบัติไม่ สามารถวัดปริมาณของแก๊สได้โดยตรง ปริมาณที่สามารถวัดได้คือความดันที่จุด A และปริมาตรแก๊ส ที่ใหลผ่านระนาบ A ในหนึ่งหน่วยเวลา ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสมการ

$$Q = \frac{PV}{t} \qquad \dots \dots (2.1)$$

เมื่อ P เป็นความคันที่จุด A

V เป็นปริมาตรแก๊สที่ใหลผ่านระนาบ A ในเวลา t วินาที

Q เป็นแรงขับ มีหน่วยเป็น Pa-m³/s

2.1.6 การวัดความดันในระบบสุญญากาศ

เครื่องมือสำหรับใช้วัดความดันในระบบสุญญากาศเรียกว่า "เครื่องวัดความดัน" หรือ "เกงสุญญากาศ" (vacuum gauge) หรือ "เกงความดัน" (pressure gauge) เครื่องวัดนี้มีหลายแบบ โดยแต่ละแบบมีความเหมาะสมที่จะวัดค่าความดันในช่วงที่ต่างกันโดยทั่วไปการวัดความดันที่มีค่า สูงๆ จะใช้หลักการที่ให้ความต่างศักย์ของแก๊สกระทำต่อเครื่องวัดโดยตรง แล้วนำแรงนั้นมาแปลงผล เป็นความดัน ส่วนการวัดความดันที่มีค่าต่ำๆ จะใช้สมบัติบางประการของแก๊สและ ใอ เช่นการนำ ความร้อนมาเป็นหลักในการวัด อาจจำแนกเครื่องวัดความดันออกเป็นชนิดต่างๆ ได้ดังนี้

- 1. เครื่องวัดแบบใฮโดรสแตติก (hydrostatic gauge) เป็นเครื่องวัดความคันที่ใช้แรง ดัน จริงของแก๊สเป็นตัวหลักในการวัด เช่น มาโนมิเตอร์ (manometer) เกจแม็คคลาวด์ (Mcleod gauge) เกจบัวคอง (bourdon gauge) เป็นต้น
- 2. เครื่องวัดแบบการนำความร้อน (thermal conductivity gauge) หลักการทำงาน ของเครื่องวัดชนิดนี้มาจากความจริงที่ว่า ค่าการนำความร้อนของแก๊สขึ้นกับค่าความดัน ตัวอย่างเช่น เครื่องวัดแบบพิรานี (Pirani gauge) เครื่องวัดแบบเทอร์มอคัปเปิล (Thermocouple gauge) เป็นต้น เครื่องวัดประเภทนี้สามารถวัดความดันได้ในช่วง 760-10⁻³ torr
- 3. เครื่องวัดแบบความหนืด (viscosity gauge) เครื่องวัดชนิดนี้ใช้หลักการที่ว่าเมื่อมี การเปลี่ยนแปลงความคันจะทำให้ความหนืดของแก๊สเปลี่ยนแปลงไปด้วย ตัวอย่างของเครื่องวัดชนิด นี้ได้แก่ เครื่องวัดแบบความหนืดแลงมัวร์ (Langmuir viscosity gauge)
- 4. เครื่องวัดแบบเรดิโอมิเตอร์ (radiometer gauge) ใช้หลักการว่า โมเลกุลที่มีอัตรา เร็วสูง (คือมีอุณหภูมิสูง) สามารถก่อให้เกิดแรงได้มากกว่าโมเลกุลที่มีอัตราเร็วต่ำ (ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ) ตัวอย่างของเครื่องวัดชนิดนี้ได้แก่ เครื่องวัดคุดเซน (Knudsen gauge)
- 5. เครื่องวัดแบบ ไอออ ในเซชั่น (ionization gauge) เครื่องวัดชนิดนี้จะวัดกระแสไฟ ฟ้าที่เกิดจากการแตกตัวของแก๊สแล้วแปลงเป็นความดันเช่น เครื่องวัดเทอร์ ไมออนิกไอออ ในเซชั่น (thermionic ionization gauge) เครื่องวัดแบบเพนนิง (penning gauge) หรือ เครื่องวัดแบบฟิลลิป (philips gauge) หรือ เครื่องวัดแบบคาโทคเย็น (cold cathode gauge) เครื่องวัดชนิดนี้จะใช้ในการวัด ความดันค่ำ เช่น เครื่องวัดแบบเพนนิงสามารถวัดความดันได้ในช่วง 10⁻² ถึง 10⁻⁶ torr ขณะที่เครื่องวัด แบบเทอร์ ไมออนิกไอออ ในเซชั่นสามารถวัดความดันได้ในช่วง 10⁻³ ถึง 10⁻⁶ torr
- 6. เครื่องวัดแบบหลอดดิสซาร์จ (discharge tube gauge) เครื่องวัดชนิดนี้มีหลักใน การทำงานว่าเมื่อใส่สนามไฟฟ้าที่มากพอเข้าไปในแก๊สความดันต่างๆ แก๊สจะสามารถเรื่องแสงได้ โดยสีของแสงที่ได้ขึ้นกับค่าความดันของแก๊ส เครื่องวัดชนิดนี้วัดความดันได้ในช่วง 5 ถึง 0.10 torr และมักจะใช้เครื่องวัดชนิดนี้ในการตรวจสอบรอยรั่วของระบบสุญญากาศ

2.2 เทคโนโลยีฟิล์มบาง

การเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศครั้งแรกทำโดย Bunsen และ Grove ในปี คศ.1852 โดย แนวคิดพื้นฐานแล้ว การเคลือบฟิล์มบางกีคือ การเรียงตัว (fabricated) โดยการตกเคลือบ (deposition) ของสารเคลือบในลักษณะของอะตอมเดี่ยวบนวัสดุรองรับ (substrate) จนเกิดเป็นชั้นของฟิล์มบางโดยฟิล์มที่ได้จะบางมาก (ระดับไมครอน) ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ฟิล์มบางในงานด้านต่างๆ มาก มาย เช่น อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สารกึ่งตัวนำ ฟิล์มตัวนำและฟิล์มตัวด้านทาน หรือ อุปกรณ์ ทางแสง เช่น เลนส์ กระจกเลเซอร์ กระจกสะท้อนแสง กระจกกรองแสงเฉพาะบางช่วงความถี่ เป็นดัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคนิคการเคลือบฟิล์มบางนี้ในการเตรียมสารตัวอย่างที่เป็นฟิล์มบาง และมีความเป็นระเบียบสำหรับใช้ศึกษาสมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุต่างๆ ในรูปของฟิล์มบาง ซึ่งสมบัติ บางประการไม่สามารถวัดได้เมื่ออยู่ในสภาพเป็นก้อน ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากในการพัฒนา วัสดุเพื่อนำไปใช้ในทางอุตสาหกรรม [2]

2.2.1 <u>กระบวนการเคลือบฟิล์มบาง^[8]</u>

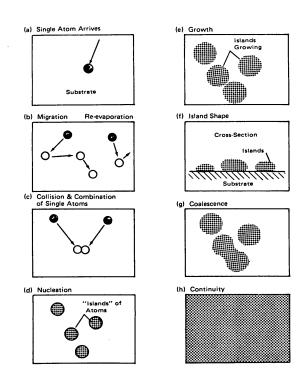
การเคลือบฟิล์มบางเป็นกระบวนการทำให้สารเคลือบตกเคลือบลงบนผิววัสดุรอง รับที่ต้องการ ซึ่งทำได้ทั้งจากกระบวนการทางเคมีหรือกระบวนการทางฟิสิกส์ โดยพื้นฐานแล้ว กระบวนการเคลือบฟิล์มบางมีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้นตอน คือ เริ่มจากการสร้างสารเคลือบในรูปของ อะตอม โมเลกุลหรืออนุภาค จากนั้นเป็นการเคลื่อนย้ายสารเคลือบมายังวัสดุรองรับ ซึ่งสุดท้ายสาร เคลือบจะมีการควบแน่นและเกิดกระบวนการพอกพูนเป็นชั้นของฟิล์มบางบนวัสดุรองรับ

หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าสารเคลือบอาจอยู่ในของแข็ง ของเหลว ใอ
หรือแก๊สก็ได้ โดยสารเคลือบนี้จะต้องทำให้อยู่ในรูปของใอระเหย ซึ่งสามารถทำได้โดยการให้ความ
ร้อนหรือการระคมยิงด้วยอนุภาคที่มีพลังงานสูง บางครั้งสารเคลือบอาจอยู่ในรูปของแก๊สหรือของ
เหลว ต่อมาเป็นการเคลื่อนย้ายสารเคลือบ (transport) โดยอาจเกิดขึ้นในสุญญากาส ซึ่งจะทำให้ใอ
ระเหยของสารเคลือบมีการเคลื่อนที่ในลักษณะเส้นตรงไปยังวัสดุรองรับ หรืออาจเคลื่อนที่ไปใน
ลักษณะของไหลซึ่งจะทำให้ไอระเหยของสารเคลือบมีการชนกับอนุภาคอื่นในภาชนะสุญญากาสบ้าง
นอกจากนี้ยังอาจเคลื่อนที่ไปในลักษณะของพลาสมาเนื่องจากพลาสมานั้นจะมีอนุภาคที่มีพลังงานสูง
อยู่มาก ซึ่งที่สำคัญในการพิจารณาถึงการเคลื่อนย้ายสารเคลือบคือต้องให้ไอระเหยของสารเคลือบมี
ความสม่ำเสมอเพื่อที่จะทำให้ฟิล์มบางที่ได้มีความสม่ำเสมอ สุดท้ายเป็นกระบวนการพอกพูนซึ่งจะ
ขึ้นกับเงื่อนใขของวัสดุรองรับหรือการทำปฏิกิริยาของสารเคลือบกับวัสดุรองรับ ตลอดจนพลังงาน
ในการเคลือบ

2.2.2 <u>การก่อเกิดฟิล์มบ</u>าง^{[13][14]}

การเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ สารเคลือบที่กระทบผิววัสดุรองรับส่วนใหญ่จะ อยู่ในรูปของอะตอมหรือโมเลกุล (รูปที่ 2.4(a)) โดยพลังงานพันธะ (bonding energy) ระหว่างอะตอม สารเคลือบกับวัสดุรองรับและอุณหภูมิของวัสดุรองรับจะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแพร่ ของสารเคลือบบนผิววัสดุรองรับ อะตอมสารเคลือบตกกระทบผิววัสดุในตำแหน่งที่เรียกว่าตำแหน่ง การดูดจับ (adsorption site) และเกิดการเกาะติดหรือถ้ามีพลังงานมากพอก็อาจกระโดดข้ามกำแพง พลังงาน ไปยังบริเวณที่อยู่ติดกันหรือหลุดออกจากตำแหน่งนั้น ไป (รูปที่ 2.4(b)) ในเวลาชั่วครู่อะตอม สารเคลือบอาจเกิดการระเหยกลับและการรวมตัวกันระหว่างอะตอมที่มีการแพร่

เมื่ออะตอมรวมตัวกันอาจเกิดเป็นอะตอมคู่ (รูปที่ 2.4(c)) ซึ่งมีความเสถียรมากกว่า อะตอมเคี่ยว ทั้งนี้การรวมตัวกันของอะตอมจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของอะตอมเคี่ยวและอัตรา เคลือบ (deposition rate) อะตอมคู่อาจรวมตัวกับอะตอมเคี่ยวอื่นแล้วกลายเป็นสามอะตอม (triplets) หรือ สี่อะตอม (quadruplets) หรืออื่นๆ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า สภาวะการเกิดนิวเคลียส (รูปที่ 2.4(d)) ทำให้ได้กลุ่มอะตอมกึ่งเสถียร (quasi-stable islands) จากนั้นกลุ่มอะตอมจะเริ่มโตขึ้นเรียกว่า การโต เป็นกลุ่มก้อน (island growth) ขนาดของกลุ่มอะตอมจะใหญ่ขึ้น โดยมีจำนวนอะตอมเท่าเดิม หรือเพิ่ม ขึ้นเล็กน้อย (รูปที่ 2.4(e) และ 2.4(f)) การโตของกลุ่มอะตอมนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งแต่ละกลุ่ม ชนกัน เรียกว่า การรวมกันเป็นก้อนของกลุ่มอะตอม (agglomeration หรือ coalescense) (รูปที่ 2.4(g))



รูปที่ 2.4 การก่อเกิดฟิล์มบาง[15]

จากการศึกษาด้วยเทคนิค Transmission Electron Microscopy (TEM) พบว่าขณะที่
กลุ่มอะตอมรวมกันเป็นก้อนอะตอมจะมีพฤติกรรมคล้ายของเหลว (liquid-like behaviour) และมีการ
จัดเรียงทิศทางในเชิงผลึกวิทยา (crystallographic orientation) ด้วย การรวมกันเข้าเป็นก้อนของกลุ่ม
อะตอมจะเกิดขึ้นจนกระทั่งฟิล์มเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 2.4(h)) แต่ในบางกรณีการเชื่อมต่อ
กันอย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์เมื่อฟิล์มมีความหนาโดยเฉลี่ยประมาณ 0.04-0.05 µm
ลักษณะผิวทั่วไปของฟิล์มขณะเกิดการรวมกลุ่มอะตอมจะดูคล้ายเนินและหุบเขา

เมื่อพิจารณาการเกิดฟิล์มในสภาวะที่เป็นกลุ่มอะตอม (island) พบว่าแต่ละกลุ่มอาจ เป็นผลึกเดี่ยว หรืออาจประกอบด้วยผลึกจำนวน 2-3 ผลึก ถ้ากลุ่มอะตอมเหล่านี้ตกเคลือบบนวัสดุรอง รับที่เป็นวัสดุหลายผลึก ทิสทางการจัดเรียงตัว (orientation) ของแต่ละกลุ่มอะตอมนั้นจะเป็นแบบสุ่ม (random) ทำให้ ได้ฟิล์มบางที่มีโครงสร้างเป็นหลายผลึกด้วย แต่ถ้ากลุ่มอะตอมเหล่านั้นตกเคลือบบน วัสดุรองรับที่เป็นผลึกเดี่ยว การจัดเรียงตัวของฟิล์ม จะเป็น ไปตาม โครงสร้างของวัสดุรองรับที่ตก เคลือบซึ่งจะได้ฟิล์มบางที่มีลักษณะเป็นผลึกเดี่ยว และเรียกกระบวนการนี้ว่าเอพิแทกซี (epitaxy)

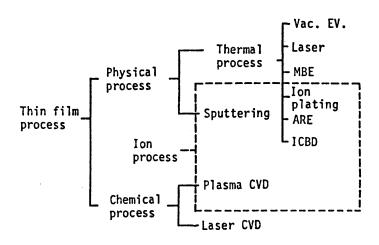
ถ้าอะตอมที่ผิวมีพลังงานเพียงพอจะทำให้มันสามารถเคลื่อนที่เพื่อเลือกเข้าไปอยู่ ในตำแหน่งที่มีพลังงานต่ำกว่าเสมอ และความสามารถในการเคลื่อนที่ (mobility) ของอะตอมจะเพิ่ม ขึ้นถ้าอุณหภูมิที่ผิววัสคุรองรับสูงขึ้น ทั้งนี้การลดอัตราเคลือบสามารถช่วยให้การโตของผลึกเกิดได้ดี ยิ่งขึ้น เพราะอะตอมมีเวลาในการโตนานพอ ดังนั้นถ้าอุณหภูมิของวัสคุรองรับสูงและมีอัตราเคลือบ ต่ำจะได้ฟิล์มที่มีเกรนขนาดใหญ่ มีข้อบกพร่องในเกรนน้อยและได้ฟิล์มที่หนามากพอสำหรับการ เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ในทางกลับกันถ้าอุณหภูมิวัสคุรองรับต่ำแต่อัตราเคลือบสูงก็จะให้ผล ลักษณะเดียวกัน

2.2.3 <u>ประเภทของการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ</u>[16]

การเคลือบฟิล์มในสุญญากาศบางอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท (รูปที่ 2.5) ได้แก่ การ เคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวนการทางเคมี (chemical process) และการเคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวน การทางฟิสิกส์ (physical process)

1) การเคลือบฟิล์มบางค้วยกระบวนการทางเคมี
เป็นการเคลือบที่อาศัยการแตกตัวของสารเคมีในสภาพของแก๊สและเกิด
ปฏิกิริยาเคมีกลายเป็นสารใหม่ (new species) ตกเคลือบบนวัสดุรองรับ เช่น วิธี plasma CVD และ
วิธี laser CVD เป็นต้น

2) การเคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์
เป็นการเคลือบที่อาศัยการทำให้อะตอมของสารเคลือบหลุดออกจากผิวแล้วฟุ้ง
กระจายหรือวิ่งเข้าไปจับและยึดติดกับผิวของวัสดุรองรับ เช่น วิธีระเหยสาร (evaporation) และ
วิธีสปัตเตอริง (sputtering) เป็นต้น



รูปที่ 2.5 ประเภทของกระบวนการเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศ [16]

2.2.4 การเคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์

การเคลือบฟิล์มบางด้วยกระบวนการทางฟิสิกส์อาศัยหลักการทำให้อะตอมของ สารเคลือบหลุดออกจากผิวแล้วฟุ้งกระจายวิ่งเข้าไปจับและยึดติดกับผิวของวัสดุรองรับแล้วพอกพูน เป็นชั้นของฟิล์มบางซึ่งเกิดขึ้นภายใต้ภาวะสุญญากาศ แบ่งเป็น 2 วิธีหลักๆ คือ

1) การเคลื่อบด้วยวิชีระเหยสาร

เป็นกระบวนการพอกพูนของชั้นฟิล์มบางของสารเคลือบที่ทำให้ระเหยซึ่งเกิด ขึ้นในสุญญากาส (ความคันประมาณ 10° mbar) ทำได้โดยการให้ความร้อนที่มากพอที่จะทำให้สาร เคลือบกลายเป็นใอ ซึ่งใอของสารเคลือบนี้จะฟุ้งไปกระทบกับวัสดุรองรับที่มีอุณหภูมิเหมาะสมก็จะ เกิดการควบแน่นของสารเคลือบและพอกพูนโตเป็นชั้นของฟิล์มบางต่อไป การให้ความร้อนในการ ระเหยสารเคลือบทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมใช้และไม่ยุ่งยากคือการให้ความร้อนแก่ภาชนะบรรจุสาร เคลือบด้วยวิธีทางไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีวิธีอื่น เช่น การให้ความร้อนจากตัวด้านทาน (resistive heating) การระเทยแบบวาบ (flash evaporation) การระเทยด้วยเลเซอร์ (laser evaporation) การระเทย ด้วยลำอิเล็กตรอน (electron beam evaporation) การระเทยด้วยการอาร์ค (arc evaporation) การให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (radiofrequency heating) การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีนี้นิยมใช้ในการ เคลือบสารไดอิเลคตริก (dielectric) เช่น แมกนีเซียมไดฟลูออไรด์ (MgF₂) หรือ ออกไซด์ (oxide) ของโลหะที่มีสมบัติโปร่งใสบนวัตถุที่ด้องการเคลือบ เช่น เลนส์กล้องถ่ายรูป แว่นตาและกระจกเลเซอร์ ฯลฯ สำหรับข้อเสียของการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีนี้คือแรงยึดติดระหว่างสารเคลือบและวัตถุรองรับ จะไม่สูงนักจึงด้องอาศัยกระบวนการอบด้วยความร้อนหรือวิธีอื่นช่วยให้การยึดเกาะของสารเคลือบฟิล์ ถ้าภาชนะ บรรจุสารเคลือบมีจุดหลอมเหลวต่ำหรือใกล้เคียงกับสารเคลือบ

2) การเคลือบด้วยวิชีสปัตเตอริง

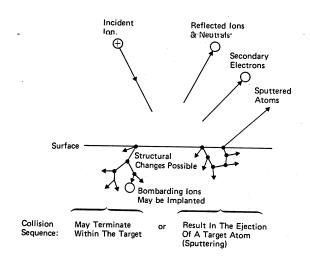
เป็นกระบวนการพอกพูนของชั้นฟิล์มบางของสารเคลือบที่ได้จากกระบวนการสปัตเตอริง (ความดันประมาณ 10⁻³ ถึง 10⁻¹ mbar) การเคลือบด้วยวิธีนี้เกิดขึ้นเมื่ออะตอมของสาร เคลือบที่ได้จากกระบวนการสปัตเตอริงวิ่งเข้าชนวัสดุรองรับและมีการพอกพูนเป็นฟิล์มบางในที่สุด กระบวนการสปัตเตอริงคือการทำให้อะตอมหลุดจากผิวของวัสดุโดยการชนของอนุภาคพลังงานสูง โดยมีการแลกเปลี่ยนพลังงานและ โมเมนตัมระหว่างอนุภาคที่วิ่งเข้าชนกับอะตอมที่ผิวสารเคลือบ กระบวนการนี้อนุภาคที่วิ่งเข้าชนอาจเป็นกลางทางไฟฟ้าหรือมีประจุก็ได้ และเนื่องจากไอออนที่ได้ จากกระบวนการสปัตเตอริงในการเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริงจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงกว่า วิธีการระเหยสารมาก ดังนั้นเมื่ออะตอมของสารเคลือบวิ่งเข้ากระทบแผ่นวัสดุรองรับก็จะฝังตัวแน่น ลงในเนื้อวัตถุที่ต้องการเคลือบมากกว่าวิธีระเหยสาร ดังนั้นการเคลือบด้วยวิธีสปัตเตอริง จะทำให้การ ซึดเกาะระหว่างสารเคลือบกับวัตถุรองรับดีกว่า

2.3 การเคลือบฟิล์มบางด้วยวิธีสปัตเตอริง

เมื่อผิวหน้าวัสคุถูกระคมยิง (bombarded) ด้วยอนุภาคพลังงานสูงจะทำให้เกิดการสึก กร่อนและมีอนุภาคที่ผิวหน้าของวัสคุนั้นหลุดออกมา เนื่องจากการชนของอนุภาคพลังงานสูงกับ อนุภาคที่ผิวหน้า ปรากฏการณ์ที่อนุภาคผิวหน้าวัสคุหลุดออกมานี้เรียกกว่า สปัตเตอริง (sputtering) กระบวนการสปัตเตอริงนี้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อ 100 กว่าปีที่ผ่านมาโดย Grove ซึ่งขณะนั้นสปัตเต อริง เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความเสียหายกับคาโทดและกริดในหลอดดิสชาร์จ แต่ปัจจุบันได้มี การนำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางเช่น การทำความสะอาดผิวหน้า (surface cleaning) การกัดเซาะ (etching) การวิเคราะห์ชั้นผิวหน้าของวัสคุ (surface layer analysis) และการเคลือบฟิล์มบาง

2.3.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสปัตเตอริง[13][17]

- 1) อันตรกิริยาระหว่างไอออนและผิวเป้าสารเคลือบ เมื่อไอออนพลังงานสูงวิ่งชนผิวหน้าวัสคุจะเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ ดังนี้
- 1. การสะท้อนที่ผิวหน้าของไอออน (reflected ions and neutrals) ไอออนอาจ สะท้อนกลับจากผิวหน้าซึ่งส่วนใหญ่จะสะท้อนออกมาในรูปของอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้าอันเกิด จากการรวมตัวกับอิเล็กตรอนที่ผิวเป้าสารเคลือบ
- 2. การปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ (secondary electron emission) จากการชน ของไอออนอาจทำให้เกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิจากเป้าสารเคลือบ ถ้าไอออนที่เข้าชนนั้น มีพลังงานสูงพอ



รูปที่ 2.6 อันตรกิริยาระหว่างไอออนและผิวเป้าสารเคลือบ [18]

- 3. การฝังตัวของไอออน (ion implantation) ไอออนที่วิ่งชนเป้าสารเคลือบนั้น ใอออนอาจฝังตัวลงในเนื้อของเป้าสารเคลือบ โดยความลึกของการฝังตัวจะแปรผันโดยตรงกับพลัง งานไอออน ซึ่งมีค่าประมาณ 10 °A ต่อพลังงานไอออน 1 keV สำหรับไอออนของแก๊สอาร์กอนที่ฝัง ตัวในแผ่นทองแดง
- 4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผิวเป้าสารเคลือบ (target material structural rearrangements) บางครั้งการชนของไอออนบนผิวเป้าสารเคลือบอาจทำให้เกิดการเรียงตัวของ อะตอมที่ผิวเป้าสารเคลือบใหม่ และเกิดความบกพร่องของโครงสร้างผลึก (lattice defect) เราเรียก การจัดตัวใหม่ของโครงสร้างผิวหน้านี้ว่า altered surface layers
- 5. กระบวนการสปัตเตอริง (sputtering) บางครั้งการชนของไอออนอาจทำให้ เกิดกระบวนการชนแบบต่อเนื่องระหว่างอะตอมของเป้าสารเคลือบ ทำให้เกิดการปลดปล่อยอะตอม จากเป้าสารเคลือบ ซึ่งกระบวนการนี้ว่า สปัตเตอริง

2) กระบวนการสปัตเตอริง

การสปัตเตอริงเป็นกระบวนการที่อะตอมผิวหน้าของวัสคุถูกทำให้หกุคออกมา ด้วยการชนของอนุภาคพลังงานสูงโดยมีการแลกเปลี่ยนพลังงานและโมเมนตัมระหว่างอนุภาคที่วิ่ง เข้าชนกับอะตอมที่ผิววัสคุดังกล่าว กระบวนการนี้อนุภาคที่วิ่งเข้าชนอาจเป็นกลางทางไฟฟ้าหรือมี ประจุก็ได้ ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นในกระบวนการสปัตเตอริง คือ

- 1. เป้าสารเคลือบ ทำหน้าที่เป็นเป้าให้อนุภาคพลังงานสูงวิ่งเข้าชนจนมีการปลด ปล่อยอะตอมของเป้าสารเคลือบลงเคลือบบนวัสคุรองรับ
- 2. อนุภาคพลังงานสูง ซึ่งจะวิ่งเข้าชนเป้าสารเคลือบ แล้วทำให้อะตอมของเป้า สารเคลือบหลุดออกมา ปกติอนุภาคพลังงานสูงนี้อาจเป็นกลางทางไฟฟ้า เช่น นิวตรอน หรืออะตอม

ของชาตุต่างๆ แต่การทำให้อนุภาคที่เป็นกลางมีพลังงานสูงเกินกว่า 10 eV เพื่อใช้ในกระบวนการ สปัตเตอริงทำได้ค่อนข้างยาก วิธีการหนึ่งที่นิยมคือการเร่งอนุภาคประจุภายใต้สนามไฟฟ้า ซึ่ง สามารถควบคุมระดับพลังงานไอออนได้ตามต้องการ อิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่มีประจุชนิดหนึ่งที่ ผลิตได้ง่ายและสามารถเร่งให้มีพลังงานสูงภายใต้สนามไฟฟ้าได้ แต่อิเล็กตรอนมีมวลน้อยกว่าอะตอม ของเป้าสารเคลือบมากทำให้การถ่ายเทพลังงานและโมเมนตัมต่ออะตอมเป้าสารเคลือบเป็นไปอย่าง ไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถทำให้กระบวนการสปัตเตอริงเกิดขึ้นได้ตามทฤษฎีทางฟิสิกส์การ ชนระหว่าง 2 อนุภาคที่มีการส่งถ่ายพลังงานและโมเมนตัมดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อมวลของอนุภาคทั้ง สองมีค่าเท่ากันดังนั้นเราจึงเลือกการเร่งไอออนของแก๊สในสนามไฟฟ้าเป็นอนุภาควิ่งชนเป้าสาร เคลือบซึ่งให้อัตราการปลดปล่อยสารเคลือบจากเป้าสารเคลือบสูงเพียงพอกับความต้องการ

3. การผลิตอนุภาคพลังงานสูง อนุภาคพลังงานสูงในระบบสปัตเตอริงนี้จะต้อง ถูกผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กระบวนการเคลือบสารเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจนได้ความหนาฟิล์ม ตามต้องการ ทั้งนี้สามารถทำได้หลายวิธีเช่นการใช้ลำอนุภาคจากปืนไอออนที่มีปริมาณการผลิต ไอออนในอัตราสูงหรือผลิตจากกระบวนการโกลว์ดิสชาร์จ เนื่องจากปืนไอออนมีราคาค่อนข้างสูง และให้ไอออนในพื้นที่แคบ กระบวนการสปัตเตอริงทั่วไปในระดับอุตสาหกรรมจึงนิยมใช้กระบวน การโกลว์ดิสชาร์จในการผลิตอนุภาคพลังงานสูง

3) ค่ายึกด์ของสปัตเตอริง (sputtering yield: S)

ค่าชีลด์ของกระบวนการสปัตเตอริง คือ ค่าเฉลี่ยปริมาณการหลุดของอะตอมเป้า สารเคลือบต่อปริมาณการชนของไอออน 1 อนุภาค มีหน่วยเป็น อะตอมต่อไอออน การวัดค่าชีลด์นี้ สามารถทำได้โดยการหาน้ำหนักหรือความหนาที่ลดลงของเป้าสารเคลือบ หรือหาได้จากวัสดุทั้งหมด ที่ถูกสปัตเตอร์ หรืออาจหาได้จากการตรวจวัดสปัตเตอร์อะตอม (sputter atom) ขณะที่ยังฟุ้งกระจาย ค่าชีลด์ของกระบวนการสปัตเตอริงจะเปลี่ยนไปตามภาวะต่างๆ ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงตามพลังงาน ใอออน การชนตรงของอนุภาค 2 อนุภาค การถ่าย เทพลังงานระหว่างอนุภาคจะเป็น ใปตามสมการ (2.2)

$$\Delta E = \frac{4 \,\mathrm{mM}}{\left(\mathrm{m} + \mathrm{M}\right)^2} \qquad \dots \dots (2.2)$$

เมื่อ ΔE คือพลังงานที่ถ่ายเทระหว่างอนุภาค

m คือมวลอะตอมที่ถูกชน

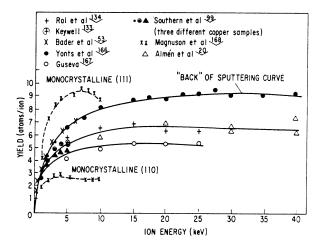
M คือมวลของอะตอมที่วิ่งเข้าชน

เมื่อพลังงานใจออนมีค่าต่ำมากค่ายืลด์จากกระบวนการสปัตเตอริงจะเป็นศูนย์ เนื่องจากไม่สามารถเอาชนะแรงยึดเกาะระหว่างอะตอมบนเป้าสารเคลือบได้ เมื่อไอออนมีพลังงานสูง ขึ้นเกินกว่า 4 H (H คือค่าพลังงานเฉลี่ยที่ใช้ในการระเหิด 1 อะตอม จากผิวสารเคลือบ) ถ้าพลังงาน ไอออนสูงมากพอในการทำให้เกิดกระบวนการชนอย่างต่อเนื่องระหว่างอะตอมสารเคลือบและเริ่มมี การปลดปล่อยอะตอมสารเคลือบ เรียกพลังงานค่านี้ว่า พลังงานขีดเริ่ม (threshold energies) ซึ่งเปลี่ยน แปลงไประหว่างคู่การชนของอนุภาค (ตารางที่ 2.3) เมื่อไอออนที่เข้าชนมีพลังงานสูงขึ้นยีลด์จะเพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็วแบบเอ็กซ์โพเนนเซียลในช่วงแรก และเปลี่ยนเป็นการเพิ่มแบบเชิงเส้น จากนั้นจึงมี การอิ่มตัว (saturation) ของค่ายีลด์ เมื่อพลังงานไอออนมีค่าสูงมาก ทั้งนี้เนื่องจากไอออนพลังงานสูงมีโอกาสในการฝังตัวบนผิวเป้าสารเคลือบสูงขึ้นทำให้ยีลด์ของสารเคลือบมีค่าคงที่ จากนั้นจะมีค่าลดลง เล็กน้อยเมื่อเพิ่มพลังงานไอออนให้สูงมากขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.7

ตารางที่ 2.3 พลังงานขีดเริ่มของเป้าสารเคลือบชนิดต่างๆ [19]

	Ne	Ar	Kr	Xe	Hg		Ne	Ar	Kr	Xe	Hg
Be	12	15	15	15		Мо	24	24	28	27	32
Al	13	13	15	18	18	Rh	25	24	25	25	
Ti	22	20	17	18	25	Pd	20	20	20	15	20
C	21	23	25	28	25	Ag	12	15	15	17	
Cr	22	22	18	20	23	Ta	25	26	30	30	30
Fe	22	20	25	23	25	W	35	33	30	30	30
Co	20	25	22	22		Re	35	35	25	30	35
Ni	23	21	25	20		Pt	27	25	22	22	25
Cu	17	17	16	15	20	Au	20	20	20	18	
Ge	223	25	22	18	25	Th	20	24	25	25	
Zr	23	22	18	25	30	U	20	23	25	22	27
Nb	27	25	26	32							

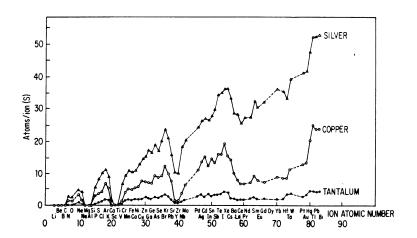
Boldface values are those for which the energy-transfer factor 4m,m,/(m,+m,)² is 0.9 or higher



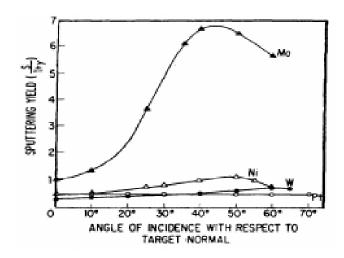
รูปที่ 2.7 ยึกด์ของทองแคงที่ถูกชนด้วยใอออนจากแก๊สอาร์กอนที่พถังงานต่างๆ [19]

2. เปลี่ยนแปลงตามระนาบผลึกของผิวเป้าสารเคลือบ จากการทดลองพบว่าเมื่อ ใช้เป้าสารเคลือบที่เป็นผลึกเคี่ยวค่ายืลด์จะมีค่ามากที่สุดเมื่อ ใอออนชนเป้าในแนวระนาบที่มีอะตอม หนาแน่นที่สุด และมีค่าต่ำในระนาบที่มีอะตอมเบาบาง ในทองแดงซึ่งมีโครงสร้างผลึกแบบ FCC (face centered cubic) พบว่าการชนบนระนาบ (111) ซึ่งมีความหนาแน่นอะตอมสูงสุด ค่ายีลด์จะมีค่า สงสคเมื่อใช้ค่าพลังงานใอออนในการชนค่าเดียวกัน ส่วนระนาบที่มีความหนาแน่นอะตอมต่ำ ไอออนมีแนวโน้มวิ่งฝังตัวในเป้าสารเคลือบมากขึ้น

3. เปลี่ยนแปลงตามชนิดของไอออนที่ชนเป้าสารเคลือบ ค่ายีลด์จากเป้าสาร เคลือบชนิคเคียวกัน เมื่อใช้ไอออนต่างชนิคกันวิ่งชนจะมีค่าแตกต่างกันออกไป แม้สมการ (2.2) จะ แสดงให้เห็นว่าการถ่ายเทพถังงานระหว่าง 2 อนุภาคที่ชนกันจะมีค่าสูงสุดเมื่อมวลของอะตอมทั้งสอง มีค่าเท่ากัน แต่อะตอมบนเป้าสารเคลือบยึดเกาะกับอะตอมข้างเคียงจึงทำตัวเสมือนมีมวลยังผลสงกว่า มวลของอะตอมเดี่ยวจึงพบว่ายีลด์มีค่าสูงขึ้นเมื่อใช้ไอออนที่มีมวลสูงกว่ามวลของอะตอมเป้าสาร เคลือบ รูปที่ 2.8 แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่ายีลด์พบว่ามีค่าสูงสุดเป็นช่วงๆ ณ ตำแหน่งที่ใช้ไอออน จากแก๊สเฉื่อย คือแก๊ส Ne , Ar , Kr , และ Xe ซึ่งเป็นอะตอมที่มีอิเล็กตรอนครบ 8 ในวงนอกสุด สาเหตุของการเกิดจุดสูงสุดของค่ายืลด์เป็นช่วงๆ นี้ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจน



รูปที่ 2.8 การเปลี่ยนแปลงค่ายีลด์ของเป้าทองแดง (Cu), เงิน (Ag) และแทนทาลัม (Ta) เมื่อใช้ใอออนพลังงาน 45 keV จากชาตุที่มีเลขอะตอมค่าต่างๆ [19]

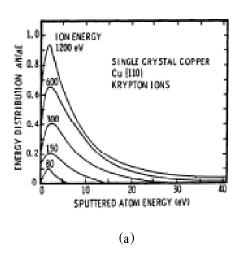


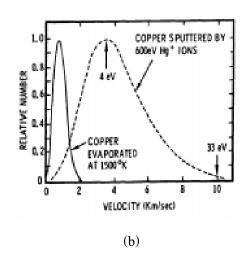
รูปที่ 2.9 การเปลี่ยนแปลงของยีลค์เมื่อใช้ใอออนของปรอทพลังงาน 200 eV ชนเป้า นิเกิล (Ni), โมลิบดินัม (Mo), ทั้งสเตน (W) และทองคำขาว (Pt) ที่มุมการตกกระทบค่าต่างๆ (วัดเทียบกับแนวชนตั้งฉากบนเป้า) [19]

4. เปลี่ยนแปลงตามมุมตกกระทบของไอออนบนเป้าสารเคลือบ ทั้งนี้จากการ ทดลองพบว่าเมื่อเพิ่มมุมเอียงของการชนจากไอออนบนเป้ามากขึ้นยีลด์จะมีค่าสูงขึ้นตามมุมที่เอียง เนื่องจากอะตอมสารเคลือบที่หลุดออกมาเปลี่ยนจาก การกระเจิงกลับ (back scattering) เป็น การ กระเจิงไปข้างหน้า (forward scattering) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องการจำนวนครั้งของการชน ระหว่างอะตอมน้อยกว่าทำให้ยีลด์สูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งซึ่งมีค่าสูงสุดที่องศาการเอียงมากกว่า 45° จาก ้นั้นยืลด์จะมีค่าลคลงเมื่อมุมสูงขึ้น และเป็นศูนย์เมื่อมุมเอียงมีค่า 90° โดยขณะนั้นพื้นที่การชนเมื่อมอง จากไอออนมีค่าเป็นศูนย์ รูปที่ 2.9

4) ความเร็วและพลังงานของอะตอมที่ถูกสปัตเตอร์

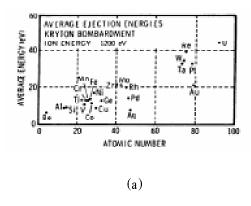
อะตอมที่หลุดออกจากผิวหน้าเป้าสารเคลือบด้วยวิชีสปัตเตอร์มีพลังงานจลน์ ค่อนข้างสูงและมากกว่าพลังงานของอะตอมที่หลุดออกด้วยวิธีการระเหยสารประมาณ 50-100 เท่า อะตอมมีการกระจายพลังงานแบบแมกซ์เวลล์ (Maxwellian) โดยพลังงานส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่า 10 eV และอีกส่วนหนึ่งมีพลังงานระหว่าง 10-40 eV ถ้าใอออนที่ใช้มีพลังงานสูงขึ้น พลังงานเฉลี่ยของ อะตอมจากสปัตเตอริงจะมีค่าสูงขึ้นจนเมื่อไอออนที่วิ่งชนมีพลังงานเกิน 1 keV พลังงานเลลี่ยของ อะตอมจากการสปัตเตอร์จะไม่เพิ่มขึ้นและเป้าที่มีค่ายืลด์สูงมีแนวโน้มทำให้พลังงานเฉลี่ยของอะตอม ที่หลุดออกมามีค่าต่ำ เนื่องจากไอออนที่วิ่งชนเมื่อเฉถี่ยพลังงานให้กับอะตอมที่หลุดออกมาจำนวน มาก อะตอมแต่ละตัวจะรับพลังงานเฉลี่ยจากไอออนได้น้อยลง (รูปที่ 2.10 และ รูปที่ 2.11)

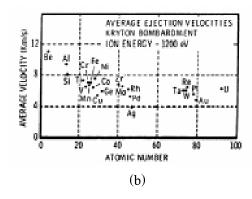




รูปที่ 2.10 (a) การกระจายค่าพลังงานของอะตอมทองแดงที่ถูกสปัตเตอร์จากไอออน ของแก๊ส Kr ที่พลังงานต่างๆ

(b) เปรียบเทียบการกระจายค่าความเร็วของอะตอมทองแดงที่ได้จากการระเหย สารและจากการสปัตเตอริง^[20]





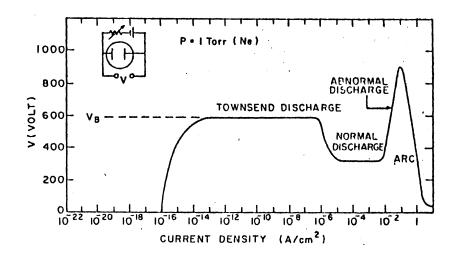
รูปที่ 2.11 (a) พลังงานเฉลี่ยของอะตอมสารเคลือบที่มีค่าเลขอะตอมต่างๆ เมื่อถูกชนด้วยไอออน ของไอออนของ Kr พลังงาน 1200 eV ที่พลังงานต่างๆ

(b) ความเร็วเฉลี่ยของอะตอมสารเคลือบที่มีค่าเลขอะตอมต่างๆ เมื่อถูกชนด้วยไอออน ${
m Kr}$ พลังงาน $1200~{
m eV}^{^{[20]}}$

2.3.2 <u>โกลว์คิสชาร์จ</u>[4][14][17][21]

เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้กับขั้วอิเล็กโตรด 2 ขั้ว ที่วางห่างกันเป็นระยะ d ภายใต้ความดันประมาณ 1.33 mbar ของแก๊สนีออน พบว่าช่วงแรกที่เพิ่มแรงดันไฟฟ้าจะมีกระแส ใหถในวงจรน้อยมาก กระแสส่วนนี้เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและใอออนของแก๊สที่เกิด ขึ้นตลอดเวลาในบรรยากาศเนื่องจากการชนของรังสีคอสมิคและถูกเร่งภายใต้สนามไฟฟ้ากระแสนี้ จะมีค่าค่อนข้างคงที่เพราะอัตราการเกิดประจุขึ้นกับความเข้มของรังสี เมื่อศักย์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นใกล้ค่า แรงดันไฟฟ้าทะลาย (breakdown voltage : $V_{\rm B}$) พลังงานของประจุที่ถูกเร่งภายใต้สนามไฟฟ้าจะมีค่า สูงขึ้นจนสามารถชนโมเลกุลของแก๊สให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนบวกและอิเล็กตรอนซึ่งจะถูกเร่ง ภายใต้สนามไฟฟ้าให้มีการชนและเกิดการไอออในซ์เพิ่มขึ้น ส่วนของไอออนบวกจะถูกเร่งเข้าชนคา โทด จนเกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิ เรียกกระบวนการช่วงนี้ว่า ทาวน์เซนต์ดิสชาร์จ (Tawnsend discharge)

ต่อมาเมื่อแรงคัน ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึงแรงคัน ไฟฟ้าทะลายก็จะเกิดกระบวนการถล่ม (avalanche) ทำให้ปริมาณไอออนบวกวิ่งเข้าชนคาโทคมากขึ้นและมีการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติย ภูมิออกมามากขึ้น ซึ่งจะถูกเร่งให้วิ่งเข้าหาอาโนด ขณะเดียวกันอิเล็กตรอนทุติยภูมินี้ก็จะมีชนกับ โมเลกุลของแก๊สทำให้เกิดไอออนออกมามากขึ้น สุดท้ายไอออนบวกที่เพิ่มมากขึ้นนี้ก็จะวิ่งเข้าชนคา โทคแล้วเกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิเพิ่มขึ้นตามมาด้วย และชนโมเลกุลแก๊สทำให้เกิดผลิต ไอออนเพิ่มขึ้นทำให้กระแสเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนมีปริมาณไอออนมากเพียงพอที่จะผลิตอิเล็กตรอน ได้ในจำนวนคงที่ ช่วงนี้ระบบสามารถรักษาสภาพดิสชาร์จได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยแหล่งกำเนิด รังสีจากภายนอกในการผลิตไอออนช่วงนี้แก๊สภายในระบบจะเกิดการเรื่องแสงขึ้น แรงคันไฟฟ้า ระหว่าง อิเล็กโตรคลคค่าลงและกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวคเร็ว เรียก การเรื่องแสงปกติ หรือ นอร์ มอลโกลว์ (normal glow) สภาวะนี้อัตราการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิต่ออัตราการชนของ ใอออนมีค่าค่อนข้างต่ำ คือประมาณ 0.1 สำหรับเป้าคาโทคที่ทำจากวัสคุทั่วไป โคยในช่วงเริ่มต้นของ การเรื่องแสงหรือโกลว์ การชนของไอออนบนคาโทคจะปรับตัวเองให้เกิดขึ้นในบางบริเวณ แนวการ เรื่องแสงอาจเลื่อนไปมาใค้และการชนของไอออนบนคาโทค ไม่มีความสม่ำเสมอโคยจะมีความเข้ม ของบริเวณการเรื่องแสงตามแนวขอบหรือมุมของคาโทคที่มีสนามไฟฟ้าสูงเพื่อรักษาสภาพการโกลว์ (self-sustaining) บางบริเวณไว้ เมื่อกระแสไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้นแนวการชนของไอออนจะค่อยๆ ขยายตัว เพิ่มพื้นที่จนครอบคลุมตลอดผิวคาโทด จนกระทั่งมีค่าความหนาแน่นกระแสเท่ากันตลอดโดยมีค่า แรงคันไฟฟ้าระหว่างขั้วอิเล็กโตรดคงที่



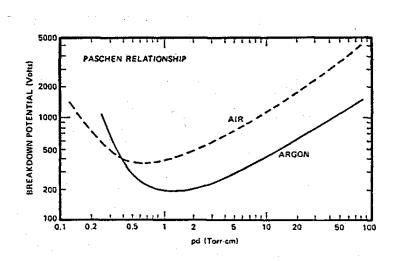
รูปที่ 2.12 ความสัมพันธ์ของความหนาแน่นกระแสและแรงคัน ไฟฟ้าระหว่างขั้วอิเล็กโตรดของ กระบวนการเกิด ดีซี โกลว์ดิสชาร์จ ในหลอดสุญญากาศบรรจูแก๊สนีออน [22]

หลังจากการชนของไอออนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของคาโทดแล้ว การเพิ่มกำลัง ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจะทำให้ทั้งแรงคันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้ามีค่าเพิ่มขึ้น เรียกว่า ช่วงการเรื่องแสงผิด ปกติ การเปล่งแสงจ้าขึ้น หรือ แอบนอร์มอลโกลว์ (abnormal glow) เป็นช่วงที่ใช้กับระบบสปัตเตอริง และอีกหลายๆ ระบบของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโกลว์คิสชาร์จ ช่วงนี้ถ้าไม่ระบายความร้อนให้ กับคาโทด เมื่อความหนาแน่นกระแสของคาโทดเพิ่มขึ้นสูงประมาณ 0.1 A/cm² ความร้อนที่เกิดจาก การชนของไอออนบวกบนผิวคาโทดจะมากขึ้น จนเกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนแบบเทอร์มิออนิค เสริมกับการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิและติดตามด้วยกระบวนการถล่มอีกครั้งหนึ่ง ทำให้ความ นำไฟฟ้าของแก๊สในระบบสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แรงคันไฟฟ้าระหว่างขั้วอิเล็กโตรดตกลงมากขณะที่ กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสูงและเปล่งประกายจ้าของการอาร์ค (arc discharge) (รูปที่ 2.12)

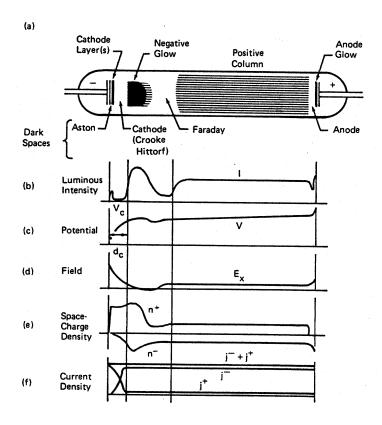
ค่าแรงคัน ไฟฟ้าทะลายในกระบวนการ โกลว์คิสชาร์จจะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปกับ ระยะทาง ประหว่างอิเล็กโตรด และระยะปลอดการชนระหว่างอิเล็กตรอนทุติยภูมิและ โมเลกุลของ แก๊ส (ระยะปลอดการชนของอิเล็กตรอนทุติยภูมินี้จะแปรผกผันกับความคัน และมีค่ามากกว่าระยะ ปลอดการชน ของการชนกันเองระหว่างโมเลกุลแก๊ส) โดยปกติอิเล็กตรอนทุติยภูมิแต่ละตัวควรมี ความสามารถในการผลิตใอออนบวกได้ระหว่าง 10 ถึง 20 ตัว เพื่อให้เกิดกระบวนการถล่ม ในช่วง ของนอร์มอลโกลว์ ถ้าความคันต่ำเกินไป (ระยะปลอดการชนยาวขึ้น) หรือระยะทาง ป มีค่าน้อยเกิน ไป อิเล็กตรอนทุติยภูมิจะ ไม่สามารถผลิตใอออนได้มากพอก่อนการชนกับอาโนด ถ้าความคันสูงเกิน ไป (ระยะปลอดการชนสั้นลง) หรือระยะ ป มากเกินไป อิเล็กตรอนทุติยภูมิไม่สามารถเพิ่มพลังงานให้ กับตัวเองในสนามไฟฟ้าได้มากพอสำหรับใช้ในการไอออไนซ์ เมื่อเกิดการชนพลังงานจะถูกถ่ายทอด ให้โมเลกุลแก๊สในรูปการกระคุ้น (excite) ขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถผลิต ไอออนบวกได้มากเพียงพอเช่นกัน ดังนั้นทั้งสองกรณีจะต้องใช้แรงดัน ไฟฟ้าทะลายที่มีค่าค่อนข้างสูง

โดยมีจุดหนึ่งระหว่างนี้ที่ใช้ค่าแรงคันไฟฟ้าทะลายต่ำที่สุดตามกฎของปาส์เซน (Paschen's law) ซึ่ง แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าทะลายและผลคูณระหว่างความดันแก๊ส (p) และ ระยะระหว่างอิเล็กโตรค (d) (รูปที่ 2.13)

ในระบบสปัตเตอริงทั่วไปสภาวะของการเกิดโกลว์ดิสชาร์จ จะกระทำในช่วงที่ผล คณของความคันกับระยะห่างระหว่างอิเล็กโตรค (pxd) ซึ่งมีค่าต่ำกว่าจดต่ำสดของกราฟมาก (เนื่อง จากการเคถือบฟิล์มที่ความคันต่ำทำให้ฟิล์มที่ได้มีคุณภาพดี การแทรกตัวของแก๊สในเนื้อฟิล์มน้อย และลดปริมาณสารปลอมปนในฟิล์ม) จึงต้องการแรงคันไฟฟ้าเริ่มต้นค่อนข้างสง บางครั้งจึงมีความ จำเป็นต้องใช้การเพิ่มความคันชั่วขณะเพื่อให้เริ่มการคิสชาร์จได้ที่แรงคันไฟฟ้าต่ำ



รูปที่ 2.13 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าทะถายและผลคูณระหว่างความดัน (p) และระยะระหว่างอิเล็กโตรค (d)^[23]



รูปที่ 2.14 โกลว์ดิสชาร์จ ของหลอดแก๊สนีออนยาว 50 cm ที่ความคัน $1.33~\mathrm{mbar}^{^{[24]}}$

ส่วนต่างๆ ของกระบวนการโกลว์คิสชาร์จ แสคงได้ดังรูปที่ 2.14 ซึ่งแต่ละส่วน อธิบายได้ดังนี้ ช่วงแรกคือช่วงมืดแอสตัน (Aston dark space) เป็นบริเวณที่อิเล็กตรอนถูกปล่อยออก จากคาโทด ด้วยพลังงานต่ำประมาณ 1 eV ซึ่งไม่สามารถไอออในซ์โมเลกุลของแก๊สได้ทำให้เกิดเป็น ช่วงมืดขึ้น ถัดออกมาจากผิวคาโทดเป็นบริเวณที่มีการเปล่งแสงออกมาด้วยความเข้มสูงมาก เรียกว่า คาโทดโกลว์ (cathode glow) เป็นบริเวณที่ไอออนของแก๊สจากการดิสชาร์จ และไอออนของอะตอม สารเคลือบซึ่งถูกผลิตขึ้นบริเวณคาโทด มีการรวมตัวเป็นกลางกับอิเล็กตรอนใกล้ผิวคาโทดด้วย กระบวนการต่างๆ ทำให้เกิดการปลดปล่อยแสงซึ่งเป็นความถี่เฉพาะของสารที่ทำคาโทดและของแก๊ส ที่ใช้เช่นเมื่อคาโทดเป็นทองแดงการเรืองแสงของคาโทดโกลว์จะมีสีเขียว ทองคำมีสีส้มแดง แก๊ส อาร์กอนมีสีน้ำเงินฟ้า และแก๊สในโตรเจนมีสีม่วงแดงเป็นด้น

ถัดจากคาโทดโกถว์ เรียกว่าช่วงมืดครุค หรือช่วงมืดคาโทด (crook or cathode dark space) พถังงานของอิเล็กตรอนมีค่าสูงกว่าพถังงานในการไอออไนซ์โมเลกุลของแก๊สเมื่อถูกเร่ง ผ่านสนามไฟฟ้าในระยะปลอดการชนออกมา ทำให้บริเวณปลอดการชนนั้นไม่มีกระบวนการกระตุ้น หรือการไอออไนซ์เกิดขึ้น การปลดปล่อยแสงจึงไม่เกิดขึ้นในช่วงนี้และกลายเป็นบริเวณมืด เลยระยะ ปลอดการชนออกไปอิเล็กตรอนทุติยภูมิจะสูญเสียพลังงานส่วนใหญ่โดยการไอออไนซ์โมเลกุลของ แก๊สและไอออนบวกที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าอิเล็กตรอนมาก ทำให้ระยะปลอดการชนของ

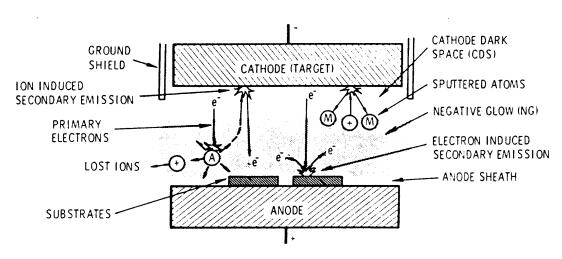
อิเล็กตรอนมีการสะสมของใอออนบวกอยู่มาก (positive space charge) ศักย์ใฟฟ้าเกือบทั้งหมดตกคร่อมบริเวณคาโทดดาร์คสเปซนี้ทำให้สนามไฟฟ้าบริเวณนี้สูงขึ้นมากและมากเกินพอในการเร่งอิเล็กตรอนชนและใอออในซ์โมเลกุลของแก๊สในเวลาถัดมาจึงทำให้ภายหลังการเกิดนอร์มอลโกลว์ แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมขั้วอิเล็กโตรดมีค่าลดลงตามกราฟในรูปที่ 2.12 ส่วนอิเล็กตรอนเมื่อเลยจากบริเวณผลิตใอออนของดาร์คสเปซแล้วจะมีพลังงานลดต่ำลงมากดังนั้นพลังงานที่เหลือจึงเพียงใช้ในการกระตุ้นโมเลกุลของแก๊สและเกิดการเรื่องแสงขึ้น แม้อิเล็กตรอนจะเป็นอนุภาคที่เคลื่อนที่ได้เร็วแต่พลังงานที่เหลือน้อยมากรวมทั้งประจุบวกจากประจุสะสมของใอออนทางด้านซ้ายมือในบริเวณดาร์คสเปซทำให้อิเล็กตรอนใช้เวลาในการเคลื่อนที่ผ่านช่วงเรื่องแสงนี้นานขึ้นและเกิดการสะสมประจุลบบริเวณนี้จึงเรียกบริเวณนี้ว่า เนกาทีฟ โกลว์ (negative glow)

หลังจากนั้นอิเล็กตรอนจะมีพลังงานลดลงจนไม่สามารถกระตุ้นโมเลกุลของแก๊ส ให้เปลี่ยนไปอยู่ในระดับพลังงานสูงขึ้นได้ ทำให้เกิดบริเวณมืดอีกช่วงหนึ่งเรียกว่า ช่วงมืดฟาราเดย์ (Faraday dark space) ถัดจากช่วงนี้กระบวนการที่เกิดขึ้นจะคล้ายกับการดิสชาร์จของทาวน์เซนด์ซึ่งมี ปริมาณอิเล็กตรอนค่อนข้างคงที่ถูกเร่งภายใต้สนามไฟฟ้าค่าต่ำๆ ทำให้อิเล็กตรอนถูกเร่งเข้าสู่อาโนด และมีพลังงงานสูงพอสำหรับการกระตุ้นโมเลกุลของแก๊สหรือ ไอออไนซ์แก๊สได้และเกิดการเรื่อง แสงขึ้นที่บริเวณนี้อีกครั้งหนึ่ง อิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนที่เร็วจะถูกกวาดเข้าสู่อาโนดโดยเร็วทำให้ พลาสมาบริเวณนี้มีประจุบวกสูงกว่าจึงเรียกว่า ถำเรืองแสงศักย์ไฟฟ้าบวก (positive glow column)

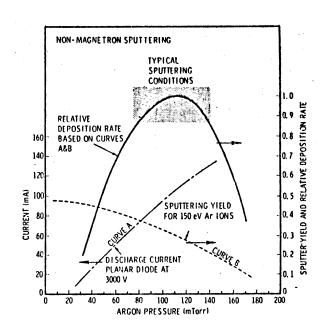
เนื่องจากการรักษาสภาวะโกลว์ดิสชาร์จขึ้นกับปริมาณของอิเล็กตรอนที่ถูกผลิตขึ้น บริเวณคาโทคจากการชนของไอออนที่ถูกผลิตบริเวณเนกาทีฟโกลว์ จึงพบว่าการเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งอาโนคเพียงเล็กน้อยจะไม่มีผลต่อกระบวนการโกลว์ดิชชาร์จ เมื่อเลื่อนอาโนคเข้าหาคาโทค จนพ้นช่วงมืดฟาราเคย์และเข้าสู่เนกาทีฟโกลว์จนเข้าสู่ช่วงคาโทคดาร์คสเปซ ทำให้ปริมาณไอออนที่ถูกผลิตจากอิเล็กตรอนทุติยภูมิมีปริมาณน้อยลง การรักษาสภาพโกลว์ดิสชาร์จไว้จำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นในการเร่งไอออนเข้าชนคาโทคด้วยพลังงานสูงและเกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิปริมาณไอออนที่ถูกผลิตสูงขึ้นด้วย การโกลว์ในลักษณะนี้จะเรียกว่า ออปสตรัคโกลว์ (obstructed glow) และเมื่อเลื่อนอาโนคเข้าใกล้คาโทคต่อมาจนพ้นขอบของ คาโทค คาร์คสเปซ ซึ่งมีระยะสั้นกว่าระยะปลอดการชนของอิเล็กตรอนจะไม่มีการผลิตไอออนเกิดขึ้นและ กระบวนการโกลว์ดิสชาร์จสิ้นสุด แม้จะเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นอีกก็ไม่สามารถคงสภาพโกลว์ดิสชาร์จ ไว้ได้ และถ้าหากมีสิ่งสกปรกบริเวณคาโทคก็อาจการอาร์คเกิดขึ้นได้โดยไม่เกิดการโกล์ดิสชาร์จก็ได้

2.3.3 <u>ระบบเคลือบแบบ ดีซี สปัตเตอริง</u> [2][4][12][17]

ระบบเคลือบแบบ ดีซี สปัดเตอริงแบบง่ายที่สุดสามารถแสดงใค้ดังรูปที่ 2.15 ซึ่ง ประกอบด้วยคาโทคคือแผ่นเป้าสารเคลือบและอาโนดใช้เป็นที่วางวัสดุรองรับหรือชิ้นงานที่ค้องการ เคลือบ ปกติระยะระหว่างคาโทดและวัสดุรองรับจะอยู่ระหว่าง 4.0-10.0 cm เพื่อป้องกันการสูญเสีย อะตอมสารเคลือบออกด้านข้างหรือผนังของภาชนะสุญญากาส โดยทั่วไประยะคาร์คสเปซอยู่ระหว่าง 1.0-4.0 cm โดยอาโนดจะอยู่บริเวณแนกาทีฟโกลว์ ส่วนอุปกรณ์ทำงานอยู่ในช่วงแอบนอร์มอลโกลว์ แก๊สที่ใช้เป็นแก๊สเฉื่อยซึ่งให้ยืลด์สูงและไม่ทำปฏิกริยากับเป้าสารเคลือบ (ปกติใช้แก๊สอาร์กอน) ขณะ เกิดโกลว์ดิสชาร์จที่ความดันค่าหนึ่ง กระบวนการไอออไนซ์จะรักษาสภาพโกลว์ดิสชาร์จไว้ตราบที่ ระยะคาร์คสเปชไม่มากกว่าระยะระหว่างคาโทดและอาโนด เมื่อความดันลดลงหรือแรงดันไฟฟ้า ระหว่างอิเล็กโตรดสูงขึ้น ระยะปลอดการชนของอิเล็กตรอนจะสูงขึ้น ทำให้ระยะดาร์คสเปชขยายตัว ออก และแหล่งผลิตไอออนในระบบมีปริมาตรน้อย กระแสไฟฟ้าจะลดลงและอะตอมที่ถูกสปัตเตอร์ มีปริมาณลดลงตามปริมาณของไอออนและกระแสไฟฟ้าในระบบ ที่ความดันด้ากว่า 10-2 mbar ระยะ คาร์คสเปชจะยาวกว่าระยะระหว่างอิเล็กโตรดและกระแสไฟฟ้าลดลงสู่ศูนย์ ทำให้กระบวนการผลิต ใอออนสิ้นสดลงและไม่มีอะตอมหลดออกจากเป้าสารเคลือบเนื่องจากการ สปัตเตอร์อีก



รูปที่ 2.15 ระบบสปัตเตอริงแบบ ดีซี สปัตเตอริง^[25]



รปที่ 2.16 ผลของความคันในระบบที่มีผลต่ออัตราเคลือบ ค่ายีลด์และกระแสไฟฟ้า ในระบบสปัตเตอริงของนิเกิลที่ใช้แรงคันไฟฟ้า 3,000 ${
m v}$ ระหว่างขั้วอิเล็กโตรคที่วางห่างกัน $4.5~{
m cm}^{[26]}$

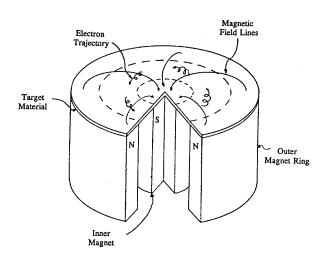
ขณะที่ความคันสูงขึ้นระยะคาร์คสเปชจะหคสั้นลง บริเวณการผลิตไอออนมีปริมาตรสูง ้ขึ้นกระแสไฟฟ้าที่ใหลในวงจรเพิ่มขึ้นและกระบวนการสปัตเตอริงเกิดขึ้นในอัตราสูงตามความดัน (รูปที่ 2.16 เส้นกราฟ A) ขณะที่ความคันภายในระบบสูงขึ้นระยะปลอดการชนระหว่างโมเลกุลของ แก๊สมีค่าลดลง อะตอมสารเคลือบที่หลุดออกจากเป้าจะส่งผ่านเคลือบบนวัสุดรองรับได้ยากจากการ ชนกับโมเลกุลของแก๊สและสะท้อนกลับสู่เป้าสารเคลือบหรือสูญเสียสู่ผนังภาชนะสุญญากาศทำให้ค่า ์ ยีลด์จากการสปัตเตอร์มีค่าลดลง แต่เมื่อความดันสงขึ้น (รปที่ 2.16 เส้นกราฟ B) ผลรวมระหว่างยีลด์ และกระแสไอออนจะทำให้อัตราเคลือบมีค่าสงสดที่ความคันค่าหนึ่ง ทั้งนี้พบว่าการสปัตเตอร์นิเกิล ้ เมื่อใช้แรงคันไฟฟ้า 3.000 V ระหว่างขั้วอิเล็กโตรคที่วางห่างกัน 4.5 cm ในแก๊สอาร์กอน การเคลือบ จะหยดที่ความคันมีค่าต่ำกว่า $2.6\mathrm{x}10^{-4}$ mbar และที่ความคันสงกว่า $1.6\mathrm{x}10^{-5}$ mbar โดยอัตราเคลือบจะ ้มีค่าสงสดและลดลงเมื่อความดันสงเกินค่านี้ ดังนั้นบริเวณที่เหมาะสมกับกระบวนการสปัตเตอริงคือ บริเวณที่ให้อัตราเคลือบสูงและประสิทธิภาพดีที่สุด จากรูป 2.16 พบว่าความดันที่เหมาะสมสำหรับ การเคลือบคือ $1.0~\mathrm{x}10^{-5}~\mathrm{mbar}$ ความหนาแน่นกระแส $1.0~\mathrm{mA/cm}^2$ ด้วยอัตราเคลือบ $0.036~\mathrm{\mu m/min}$ ซึ่ง เป็นอัตราเคถือบที่ก่อนข้างต่ำในขณะที่ใช้แรงคันไฟฟ้าค่อนข้างสูง

ระบบสปัตเตอริงทั่วไปจะต่ออาโนคลงกราวค์รวมกับภาชนะสุญญากาศและให้คาโทค มี ศักย์ไฟฟ้าลบ โดยแยกขั้วคาโทคและผิวของภาชนะสุญญากาศด้วยฉนวน เรียกว่า กราวค์ชีลค์ (ground shield) คังแสคงในรูปที่ 2.15 กราวค์ชีลค์จะมีลักษณะเป็นผนังโลหะหุ้มรอบๆ ขอบของคา โทค โดยจะต้องจัดระยะระหว่างคาโทคและกราวค์ชีลค์ให้สั้นกว่าระยะคาร์คสเปช คังนั้นแม้ว่าศักย์ ไฟฟ้าของ กราวค์ชีลค์จะเท่ากับอาโนคการโกลว์คิสชาร์จและสปัตเตอริงจะไม่สามารถเกิดกับคาโทค ในบริเวณที่มีกราวค์ชีลค์หุ้มอยู่ทำให้สามารถควบคุมบริเวณที่ต้องการสปัตเตอร์ได้

2.3.4 ระบบเคลือบแบบ คีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง [2][4][17][21]

อัตราการเกิดสปัตเตอริงนั้นจะขึ้นกับผลคูณระหว่างยืลด์และปริมาณไอออนที่วิ่ง ชนเป้าสารเคลือบ ดังนั้นการเพิ่มอัตราการสปัตเตอร์นั้นนอกจากจะทำได้โดยการเพิ่มยีลด์แล้วยังทำ ได้โดยการเพิ่มปริมาณไอออนที่วิ่งเข้าชนเป้าสารเคลือบ ซึ่งในระบบ ดีซี สปัตเตอริง ปกตินั้น ทำได้ เพียงการเพิ่มแรงดันไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโตรด หรือเพิ่มความดัน ซึ่งจะมีขีดจำกัดสูงสุดที่ ความหนา แน่นกระแสประมาณ 1 mA/cm² และความดันประมาณ 1.33 x10⁻³ mbar นอกจากนี้ยังพบว่าในระบบ ดีซี สปัตเตอริง ทั่วไปอะตอมของแก๊สที่จะเกิดการไอออไนซ์มีค่าน้อยกว่า 1% นอกจากนี้ยังมีข้อเสีย เมื่อความดันสูงขึ้นจะทำให้ปริมาณแก๊สที่แทรกตัวในฟิล์มบางที่ได้มีค่าสูงด้วย

ต่อมามีการพัฒนาระบบใหม่เรียกว่า ระบบคีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง ซึ่งเป็นการ ใช้สนามแม่เหล็กช่วย โดยจ่ายสนามแม่เหล็กให้มีทิสขนานกับผิวหน้าเป้าสารเคลือบและมีทิสตั้งฉาก กับสนามไฟฟ้าซึ่งจะช่วยเพิ่มระยะทางเดินของอิเล็กตรอนให้ยาวขึ้น โดยอำนาจของสนามแม่เหล็กจะ ทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นทางโค้ง (รูปที่ 2.17) ทำให้การไอออไนซ์เนื่องจากการชนระหว่าง อิเล็กตรอนกับอะตอมแก๊สเฉื่อยมีค่าสูงขึ้นซึ่งจะทำให้อัตราการสปัตเตอร์สูงขึ้นด้วย



รูปที่ 2.17 การเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก[27]

ทั้งนี้จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก พบว่าถ้า อิเล็กตรอนมีทิสทางการเคลื่อนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก อิทธิพลของสนามแม่เหล็กจะทำให้อนุภาค ประจุนั้นเคลื่อนที่ในแนววงกลม (รูปที่ 2.18(a)) คัวยรัศมี

$$r = \frac{3.37 (W)^{\frac{1}{2}}}{B}$$
 (2.3)

เมื่อ W คือพลังงานของอิเล็กตรอนในหน่วย eV

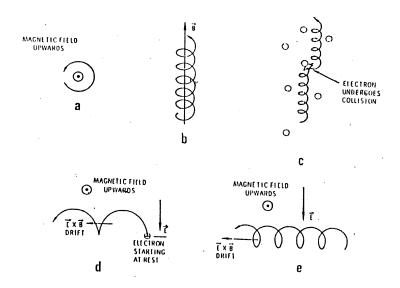
คือความเข้มสนามแม่เหล็กในหน่วย gauss หมุนด้วยความถี่ไซโคลตรอน $\nu = 2.8 \mathrm{x} 10^6 \ \mathrm{Hz}$

ถ้าพลังงานเฉลี่ยของอิเล็กตรอนในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กมีค่า 10 eV และ สนามแม่เหล็กมีค่าความเข้ม 100 gauss รัสมีการหมุนมีค่าเท่ากับ 0.1 cm ด้วยความถี่การหมุนเท่ากับ 2.8x10⁸ Hz รูปที่ 2.18(b) แสดงอิเล็กตรอนมีความเร็วส่วนหนึ่งในแนวขนานกับสนามแม่เหล็ก อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่หมุนควงรอบแนวสนามแม่เหล็กด้วยจำนวนเส้นแรงคงที่ค่าหนึ่งระหว่างนี้ถ้า อิเล็กตรอนชนกับอะตอมแก๊ส รูปที่ 2.18(c) แนวการหมุนควงรอบสนามแม่เหล็กจะเปลี่ยนไป ถ้า อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ภายในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าซึ่งมีทิศทางตั้งฉากกัน อำนาจของสนามทั้ง สองนอกจากจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในแนวโค้งแล้วยังสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง ฉากกับสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเรียกว่า การเคลื่อนที่แบบลอยเลื่อน (drift motion) มีค่าเท่ากับ

$$V_{E} = \frac{10^{8} E}{R}$$
 (2.4)

เมื่อ E คือสนามไฟฟ้าหน่วยเป็น V/cm

คือความเข้มสนามแม่เหล็กในหน่วย gauss



รูปที่ 2.18 การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามต่างๆ โดยที่

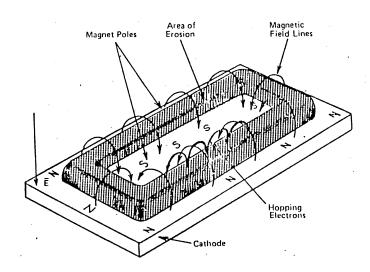
a, b, c เป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กอย่างเดียว
ส่วน d และ e เป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กและ
สนามไฟฟ้าร่วมกันในลักษณะต่างๆ [28]

กรณีสนามไฟฟ้าบริเวณดาร์คสเปซมีค่าประมาณ 1,000 V/cm และสนามแม่เหล็ก 100 gauss จะให้ค่าความเร็วลอยเลื่อน (drift velocity) เท่ากับ 10⁷ m/s ซึ่งเป็นค่าที่ค่อนข้างสูงกรณีพลัง งานเริ่มต้นของอิเล็กตรอนมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับพลังงานที่ได้รับจากสนามไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของ อิเล็กตรอนจะเป็นรูปไซคลอยด์ (cycloid) ดังรูปที่ 2.18(d) ถ้าอิเล็กตรอนมีพลังงานเริ่มต้นสูงกว่าพลัง งานที่ได้รับจากสนามไฟฟ้า การเคลื่อนที่แบบลอยเลื่อนจะอยู่ในแนววงกลมซ้อนกันดังแสดงในรูปที่ 2.18(e) พฤติกรรมที่ปรากฏต่ออิเล็กตรอนนี้จะเค่นชัดมาก ถึงแม้จะใช้สนามแม่เหล็กมีค่าน้อยๆ ระหว่าง 50-500 gauss แต่จะมีผลในการเบี่ยงเบนแนวทางเดินของไอออน (ซึ่งมีมวลสูงกว่า อิเล็กตรอนมาก) อย่างไม่เค่นชัด

ระบบสปัตเตอริงที่ใช้สนามแม่เหล็กช่วยเพิ่มปริมาณไอออนนั้น ถ้าสนามแม่เหล็กมี ทิสทางขนานกับสนามไฟฟ้าจะเรียกว่า สนามตามยาว (longitudinal field) จะทำให้ประสิทธิภาพการ เพิ่มไอออนไม่สูงนักแต่ไม่ทำให้แนวการเกิดโกลว์คิสชาร์จเปลี่ยนแปลงไปและยังสามารถรักษาความ สม่ำเสมอของฟิล์มบางไว้ได้ดี กรณีของสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าเรียกว่า สนามตามขวาง (transverse field) โดยกระบวนการเพิ่มปริมาณไอออนเกิดขึ้นดังนี้ หลังจากที่ไอออนบวกชนกับเป้า สารเคลือบและเกิดการปลดปล่อยอิเล็กตรอนทุติยภูมิออกมา อิเล็กตรอนทุติยภูมิจะเคลื่อนที่ใน ลักษณะเคียวกับรูปที่ 2.18(d) ทำให้อิเล็กตรอนถูกกักอยู่ในบริเวณสนามแม่เหล็กใกล้คาโทดและ เคลื่อนที่แบบลอยเลื่อนไปตามแนวผิวหน้าของคาโทด (รูปที่ 2.19) ทำให้อิเล็กตรอนมีโอกาสชนกับ โมเลกุลแก๊สบริเวณผิวหน้าเป้าสารเคลือบมากขึ้นจนเพิ่มปริมาณไอออนสูงมากใกล้ผิวเป้าสารเคลือบ

อิเล็กตรอนตัวใดที่ไม่ชนโมเลกุลของแก๊สจะเดินทางเป็นวงโค้งเข้าชนเป้าสารเคลือบและผลิต อิเล็กตรอนทุติยภูมิมากขึ้นเป็นผลทำให้ไอออนถูกผลิตในปริมาณสูงมากและเกิดใกล้ผิวคาโทด ทำให้ เกิดสเปซชาร์จ (space charge) จากไอออนบวกสูงที่ผิวคาโทด ซึ่งอาจสั้นกว่าระยะปลอดการชนของ ระบบ ดีซี สปัตเตอริงที่ความดันใช้งานมาก แรงเคลื่อนไฟฟ้าเกือบทั้งหมดจะตกคร่อมบริเวณนี้ และมี ค่าสนามไฟฟ้าสูงกว่าบริเวณดาร์คสเปซใน ดีซี สปัตเตอริงขณะไม่มีสนามแม่เหล็กมากทำให้ความ ต้องการแรงดันไฟฟ้าระหว่างขั้วอิเล็กโตรดของระบบ แมกนีตรอน สปัตเตอริง ลดลง มีค่าประมาณ 300-800 V ถ้าใช้สนามแม่เหล็กกับแมกนี ตรอนทรงกระบอกจะเรียกว่า แมกนีตรอน สปัตเตอริงที่ใช้เป้า แบบแผ่นราบจะเรียกว่า พลานาร์แมกนีตรอน สปัตเตอริง (planar magnetron sputtering)

ในระบบแมกนี้ตรอน สปัตเตอริง ไอออนและพลาสมาที่เกิดขึ้นเข้มมากบริเวณเป้า สารเคลือบทำให้อัตราการสปัตเตอร์ของระบบมีค่าสูง ขณะที่ใช้ความคันต่ำและแรงคัน ไฟฟ้าระหว่าง อิเล็กโตรดมีค่าเกือบคงที่ที่ทุกค่าของอัตราการสปัตเตอร์ แมกนีตรอนสปัตเตอริงทรงกระบอกทั่วไปมี อัตราการสปัตเตอร์สูงกว่า 1.0 µm/min และมีอัตราเคลือบสูงกว่า 0.2 µm/min ความหนาแน่นกระแสที่ ผิวคาโทด ประมาณ 20.0 mA/cm² แรงคันไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโตรดมีค่าระหว่าง 300-800 V ที่ความ คันประมาณ 5.33x10⁻³ mbar ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบสูงขึ้นกว่า 10 เท่าตัว นอก จากนี้ยังสามารถขยายสเกลใช้กับระบบสปัตเตอริงขนาดใหญ่ได้ง่าย ส่วนข้อเสียของระบบแมกนี้ตรอน สปัตเตอริง คือแรงคัน ไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโตรดมีค่าต่ำ จึงมีข้อจำกัดในการเคลือบวัสดุบางชนิดที่ ต้องการแรงคันไฟฟ้าสูงเพื่อควบคุมคุณภาพฟิล์ม แต่มีข้อได้เปรียบที่ระบบนี้สามารถคุมอิเล็กตรอน ส่วนใหญ่ให้อยู่ภายในกรอบสนามแม่เหล็กจึงมีอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาและวิ่งเข้าสู่วัสดุรองรับ ปริมาณน้อยซึ่งช่วยลดปัญหาความร้อนบนวัสดุรองรับเนื่องจากการชนของอิเล็กตรอนลงได้อย่างมาก



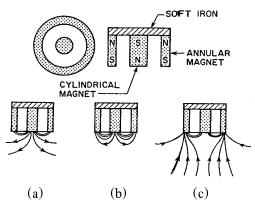
รูปที่ 2.19 การจัดสนามแม่เหล็กและแนวการกัดกร่อนของเป้าสารเคลือบ ในระบบพลานาร์แมกนีตรอน สปัตเตอริง^[29]

2.3.5 ระบบเคลือบแบบ อันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง [30][31][32][33]

ในกระบวนการเคลือบฟิล์มนั้น พบว่าหากการระคมยิงใอออนระหว่างที่สาร เคลือบมีการตกเคลือบและการก่อตัวเป็นฟิล์มนั้นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสมบัติของฟิล์มหลายอย่าง เช่น พฤติกรรมการเกิดนิวเคลียส (nucleation behaviour) สัณฐานวิทยา (morphology) องค์ประกอบ (composition) ทิสทางการจัดเรียงตัว และสมบัติเชิงกล เป็นต้น เช่น ในกรณี แมกนีตรอน สปัตเตอริง ไอออนที่ใช้ในการระคมยิงวัสคุรองรับจะมาจากประจุไฟฟ้าที่อยู่รอบวัสคุรองรับ ซึ่งทำได้โดยการ จ่ายสักย์ไฟฟ้าลบประมาณ -1 ถึง -500 V ให้กับวัสคุรองรับ ทั้งนี้ความหนาแน่กระแสที่ฟิล์มหรือผิว หน้าของวัสคุรองรับ สำหรับ ระบบคีซี แมกนีตรอน ปกติจะมีค่าต่ำประมาณ 0.05-0.10 ไอออน/อะตอมสารเคลือบ แต่การใช้งานจริงต้องมีค่าสูงกว่านี้

สำหรับการเคลือบแข็ง (hard coating) ฟิล์มที่ต้องการนั้นจะต้องมีช่องว่าง (voids) ในเนื้อฟิล์มน้อยที่สุด ซึ่งจะทำให้ฟิล์มบางที่ได้นั้นมีความทนต่อการกัดกร่อน (corrosion) และทนต่อ การขัดสี (wear resistance) มากขึ้น การลดช่องว่างในเนื้อฟิล์มนี้ทำได้โดยการเพิ่มความต่างศักย์ใบ แอสให้กับวัสดุรองรับ แต่ก็จะทำให้เกิดความเค้นและความบกพร่อง (defects) ภายใน เกรน (grain) ของฟิล์มมากขึ้นเมื่อความต่างศักย์ใบแอสเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้คุณภาพของฟิล์มและการยึดติดของฟิล์ม กับวัสดุรองรับลดลง ปัญหานี้แก้ได้โดยการเพิ่มความหนาแน่นของกระแสไอออนที่ใช้ ซึ่งทำได้โดย ใช้ระบบเคลือบแบบอันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง (unbalanced magnetron sputtering)

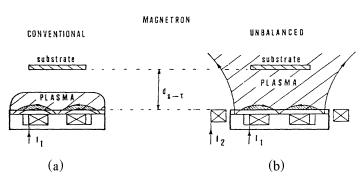
ระบบอันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง ได้รับการคิดค้นและตีพิมพ์เผยแพร่ โดย Window และ Savvides ครั้งแรกในปี ค.ส.1986 โดยทั้งสองพบว่าการติดตั้งแม่เหล็กที่คาโทด ของระบบสปัตเตอริงปกติ หากทำให้ความเข้มของสนามแม่เหล็กด้านใดด้านหนึ่งมากหรือน้อยกว่า อีกด้านหนึ่งแล้วสนามแม่เหล็กที่คาโทดมีลักษณะ ไม่สมมาตร ทำให้ปริมาณ ไอออนที่วิ่งเข้าชนหรือ ระคมยิงวัสดุรองรับ (ฟิล์มบาง) นั้นมีปริมาณมากกว่าปกติ ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพของฟิล์มบางที่เคลือบ ได้โดยตรง การจัดแม่เหล็กของระบบนี้อาจแบ่งเป็น 3 แบบ คือความเข้มสนามของแม่เหล็กที่ด้านใน มากกว่าด้านนอก (รูปที่ 2.20 (a)) หรือกลับกัน (รูปที่ 2.20 (c)) หรือใกล้เคียงกัน (รูปที่ 2.20 (b))



รูปที่ 2.20 ลักษณะเส้นแรงแม่เหล็กของระบบอันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง^[34]

การ จัดแม่เหล็กตามรูปที่ 2.20(a) ใอออนที่ระดมยิงวัสคุรองรับจะมีค่าต่ำ (อัตราส่วนใอออน/อะตอมสารเคลือบประมาณ 0.25:1) ส่วนการ จัดแม่เหล็กตามรูปที่ 2.20(c) ใอออนที่ ระดมยิงวัสคุรองรับจะมีค่าเพิ่มขึ้น ทำให้อัตราส่วนใอออน/อะตอมสารเคลือบมีค่าสูงขึ้นคือประมาณ 2:1 (เมื่อใช้ความต่างสักย์ใบแอสต่ำ) จากการศึกษาของ Musil และ Kadlec ที่ใช้ระบบเคลือบแบบอัน บาลานซ์ พลานาร์ แมกนีตรอนเดี่ยวและขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ขด เคลือบไททาเนียมในไตรค์ที่ ระยะเป้าสารเคลือบและวัสคุรองรับประมาณ 200.0 mm ใช้ความต่างสักย์ใบแอสในช่วง -5 ถึง -100 V พบว่าความหนาแน่นกระแสสูงถึง 6.0 mA/cm² ซึ่งมากพอสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม

หากเปรียบเทียบระบบสปัตเตอริงทั้ง 3 ระบบ พบว่าในระบบสปัตเตอริงปกตินั้น อิเล็กตรอนที่ได้จากการไอออในช์จะวิ่งไปจับอาโนคโดยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสปัตเตอริงเลย ดังนั้นเพื่อให้ระบบสปัตเตอริงมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีแนวคิดที่จะนำอิเล็กตรอนเหล่านี้เข้ามาช่วย ในกระบวนการสปัตเตอริงโดยการใช้สนามแม่เหล็กช่วย จึงเกิดระบบแมกนีตรอน สปัตเตอริง ซึ่งใช้ สนามแม่เหล็กช่วยทำให้เกิดอิเล็กตรอนบริเวณหน้าคาโทดเพิ่มขึ้น (เนื่องจากอิเล็กตรอนเหล่านี้มีส่วน ช่วยทำให้กระบวนการสปัตเตอริงคงอยู่อย่างต่อเนื่อง) อำนาจของสนามแม่เหล็กจะทำให้อิเล็กตรอนเหล่านี้มีส่วน เคลื่อนที่เป็นทางโค้งทำให้การไอออนในซ์แก๊สเฉื่อยสูงขึ้น นอกจากนี้สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า ยังทำให้การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่วิ่งชนเป้าสารเคลือบมีลักษณะเป็นการชนแบบซ้ำๆ ต่อเนื่องกัน ทำให้เกิดอิเล็กตรอนทุติยภูมิปริมาณนี้มากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการสปัตเตอร์มากตามไปด้วย แต่ก็ยังมี อิเล็กตรอนบางส่วนที่มีพลังงานสูงสามารถหลุดจากอำนาจของสนามแม่เหล็กนี้วิ่งเข้าหาขั้วอาโนด โดยทันที สำหรับในระบบอันบาลานซ์ แมกนีตรอน สปัตเตอริง นั้นอิเล็กตรอนพลังงานสูงที่หลุดจาก สนามแม่เหล็กนี้จะถูกยึดไว้ด้วยเส้นแรงแม่เหล็กส่วนเกินของระบบแล้วเคลื่อนที่เป็นทางโค้งไปตาม เส้นแรงแม่เหล็กเข้าชนกับอะตอมของแก๊สเฉื่อและเกิดการไอออในซ์เป็นพลาสมาบริเวณผิวหน้า วัสคุรองรับทำให้ความหนาแน่นกระแสที่วัสดุรองรับมีค่าสูงกว่าในระบบแมกนีตรอน สปัตเตอริง มาก (ประมาณ 5.0-10.0 mA/cm² ปกติมีค่าน้อยกว่า 1.0 mA/cm²)



รูปที่ 2.21 ลักษณะพลาสมาของระบบสปัตเตอริง[31]

- (a) ระบบบาลานซ์แมกนีตรอน สปัตเตอริง
- (b) ระบบอันบาลานซ์แมกนีตรอน สปัตเตอริง

2.4 <u>อุปกรณ์ในระบบ แมกนีตรอน สปัตเตอริง</u>^{เม}

ในการออกแบบและสร้าง ระบบเคลือบแบบ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง นั้นปกติแล้วมี ส่วนประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ ดังนี้คือ คาโทดและเป้าสารเคลือบ วัสคุรองรับ ระบบสุญญากาส แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ระบบป้อนแก๊ส ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

2.4.1 คาโทดและเป้าสารเคลือบ

ในการออกแบบคาโทคและการติดตั้งเป้าสารเคลือบให้มีรูปร่างต่างๆ เพื่อความ เหมาะสมกับประเภทของงานมีสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ 5 ส่วน คือ ระบบหล่อเย็น ระบบฉนวนของไฟฟ้าแรงสูงและรอยต่อ สนามแม่เหล็ก คาโทคซีลด์ และวัสดุที่ใช้ในการสร้าง

1. ระบบหล่อเย็น พลังงานที่ใช้ในกระบวนการสปัตเตอริงที่ทำให้เกิดการปลด ปล่อยอนุภาคจากเป้าสารเคลือบจะมีค่าประมาณ 1% ส่วนพลังงานที่ใช้เปลี่ยนเป็นความร้อนที่เป้าสาร เคลือบจากการชนของไอออนที่ผิวเป้าในกระบวนการสปัตเตอริงจะมีค่าประมาณ 75% และส่วนที่ เหลือคือพลังงานที่ใช้ในการผลิตอิเล็กตรอนทุติยภูมิ และทำให้เกิดพลาสมาในระบบซึ่งจะวิ่งชนและ กลายเป็นพลังงานความร้อนบนวัสดุรองรับและผนังภาชนะสุญญากาศ พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้น บนเป้าสารเคลือบนี้มีค่าสูงมากจนอาจละลายเป้าสารเคลือบได้ ทั้งสามารถก่อปัญหาเกิดการแพร่ที่ แตกต่างกันของชาตุต่างชนิดในการเคลือบอัลลอย ทำให้ฟิล์มเคลือบมีปริมาณชาตุในอัลลอยแตกต่าง จากเป้าสารเคลือบมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดิตดั้งระบบหล่อเย็นเข้ากับคาโทดและเป้าสารเคลือบเพื่อ ป้องกันปัญหาดังกล่าว การหล่อเย็นอาจใช้น้ำหรือน้ำมันเป็นวัสดุหล่อเย็น น้ำมันมีคุณสมบัติเป็น ฉนวนไฟฟ้าดีกว่าน้ำและทำให้เกิดการกัดกร่อนของเนื้อวัสดุที่ใช้ทำคาโทดต่ำกว่าน้ำ แต่ประสิทชิ ภาพในการทำความเย็นน้อยกว่าน้ำและมีราคาแพงรวมทั้งมีความหนืดสูงทำให้ด้องใช้เครื่องสูบขนาด ใหญ่ และก่อให้เกิดความสกปรกแก่ระบบสุญญากาศได้ง่าย น้ำแม้จะมีความนำไฟฟ้าสูงกว่าและต้องใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้าแรงสูงที่คาโทด แต่มีราคาถูก

การหล่อเย็นอาจให้เป้าสารเคลือบสัมผัสโดยตรงกับน้ำโดยซีลด์กันน้ำรั่วใหลด้วย แผ่นยางระหว่างคาโทดกับแผ่นเป้าสารเคลือบ หรืออาจออกแบบคาโทดปิดด้วยแผ่นปิดหลัง (backing plate) กันน้ำรั่วใหล และติดแผ่นเป้าสารเคลือบโดยการเชื่อมติดเข้ากับแผ่นปิดหลัง การยึดแผ่นเป้ากับ แผ่นปิดหลังด้วย สกรูยึดทำให้การระบายความร้อนไม่ดีทุกผิวสัมผัส และทำให้เกิดการโก่งงอของ แผ่นเป้าหนีการสัมผัสระบายความร้อนอันทำให้เกิดความเสียหายกับเป้าสารเคลือบได้วัสดุทั่วไปที่ใช้ ทำแผ่นปิดหลังของคาโทดคือทองแดงเนื่องจากนำความร้อนได้ดีและต้องมีความหนาเพียงพอในการ ทนความดันบรรยากาสและความดันน้ำที่ใช้ในการหล่อเย็นโดยไม่เกิดการโปงนูนออก

ตารางที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใหลของน้ำหล่อเย็นเมื่อใช้กำลังไฟฟ้าค่าต่างๆ ที่ความ แตกต่างอุณหภูมิน้ำเข้าและน้ำออกของระบบหล่อเย็นไม่เกิน 10°C [4]

Power dissipated	Water f	low rate	Power dissipated	Water flow rate		
(KW)	(liter/min)	(gal/min)	(KW)	(liter/min)	(gal/min)	
2	2.8	0.74	15	21	5.6	
4	5.6	1.5	20	28	7.4	
6	8.4	2.2	25	35	9.3	
8	11.2	3.0	30	42	11.0	
10	14.0	3.7				

ในการออกแบบน้ำหล่อเย็นนิยมควบคุมให้อุณหภูมิน้ำขาเข้าและขาออกแตกต่าง กันไม่เกิน 10 °C อุณหภูมิน้ำขณะหล่อเย็นควรมีค่าสูงกว่าจุดกลั่นตัวของไอน้ำในอากาสเพื่อป้องกัน การจับตัวของไอน้ำขณะคาโทคเปิดออกสัมผัสบรรยากาส ซึ่งอาจเกิดการลัดวงจรหรือลดความดันลง ยากในการเคลือบครั้งต่อไป ความนำไฟฟ้าของน้ำที่ใช้ควรมีค่าต่ำ โดยมีความด้านทานจำเพาะสูงกว่า 10 kΩ-cm เพื่อลดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าจากขั้วคาโทดสู่กราวด์ของระบบน้ำหล่อเย็น ปริมาณของน้ำ หล่อเย็นต่ำสุดที่ใช้กับระบบหล่อเย็นสัมพันธ์กับกำลังงานไฟฟ้าของระบบสปัตเตอริง (ตารางที่ 2.4)

- 2. ฉนวนใฟฟ้าแรงสูงและรอยต่อวงจรไฟฟ้า เนื่องจากคาโทดและเป้าสารเคลือบ จะต่อเข้ากับศักย์ไฟฟ้าแรงสูง ขณะที่ภาชนะสุญญากาศเป็นกราวด์ ดังนั้นจึงต้องใช้ฉนวนไฟฟ้ากั้น ฉนวนนี้ต้องมีคุณสมบัติในการชีลระบบสุญญากาศได้ดี อาจใช้ชีลด์โลหะ-เซรามิค หรือใช้ เทฟรอน (TEFLON) และแผ่นยางชีลสุญญากาศร่วมกัน ท่อน้ำต้องใช้ท่อยางซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าและควรให้มี ความยาวมากสัมพันธ์กับขนาดท่อเพื่อลดการสูญเสียกำลังไฟฟ้าผ่านน้ำจากคาโทดสู่กราวค์ ถังน้ำ หล่อเย็นควรต่อลงกราวด์และขั้วต่อไฟฟ้าแรงสูงควรมีฉนวนหุ้มเพื่อป้องกันอันตราย ส่วนรอยต่อไฟฟ้าทุกจุดควรยึดด้วยโบลท์และนัทขันแน่นหรือเชื่อมติดกัน
- 3. สนามแม่เหล็ก ระบบพลานาร์ แมกนีตรอน สปัตเตอริงสนามแม่เหล็กจะตั้งฉาก กับสนามไฟฟ้าทั้งหมด การกัดกร่อนเป้าสารเคลือบเกิดขึ้นสูงในบริเวณที่สนามแม่เหล็กมีความเข้ม สูง การกัดกร่อนผิวเป้าสารเคลือบจะเป็นรูปตัววีลึงลงเป็นบางบริเวณ อายุการใช้งานของเป้าสาร เคลือบจะสิ้นสุดลงเมื่อร่องลึกปรากฏเท่ากับความหนาของเป้า ดังนั้นการจัดขั้วแม่เหล็กให้มีการ เคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ย่อมสามารถทำให้การกัดกร่อนจากกระบวนการสปัตเตอริงกระจายออกทั่ว แผ่นเป้าและลดความสิ้นเปลืองจากการใช้เป้าอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

สนามแม่เหล็กที่ใช้อาจใช้ได้ทั้งแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กไฟฟ้าโดยติดตั้งไว้ภาย นอกแต่แม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถติดตั้งชิดกับเป้าสารเคลือบได้ เนื่องจากไม่สามารถจุ่มขดลวดแม่ เหล็กไฟฟ้าไว้ในระบบน้ำหล่อเย็นซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าค่าเดียวกับคาโทดได้ ดังนั้นจึงอาจติดตั้งไว้ภายนอก